

Test First = Erst Testen, dann Denken?

Test-Driven Development
von Embedded Systemen

Dipl.-Ing. Univ.

Remo Markgraf

MicroConsult GmbH

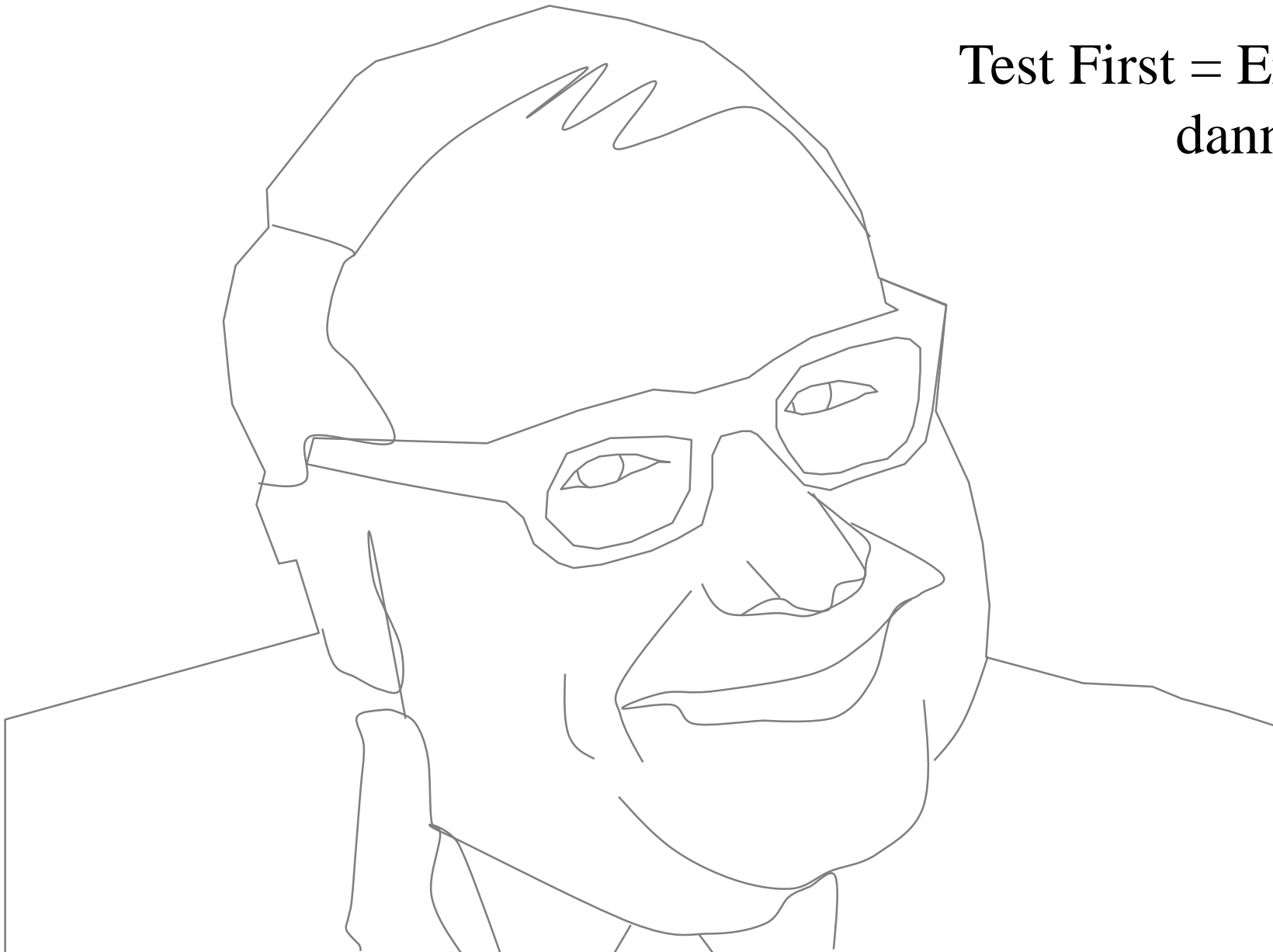


Sie dürfen nicht alles glauben,
was Sie denken!

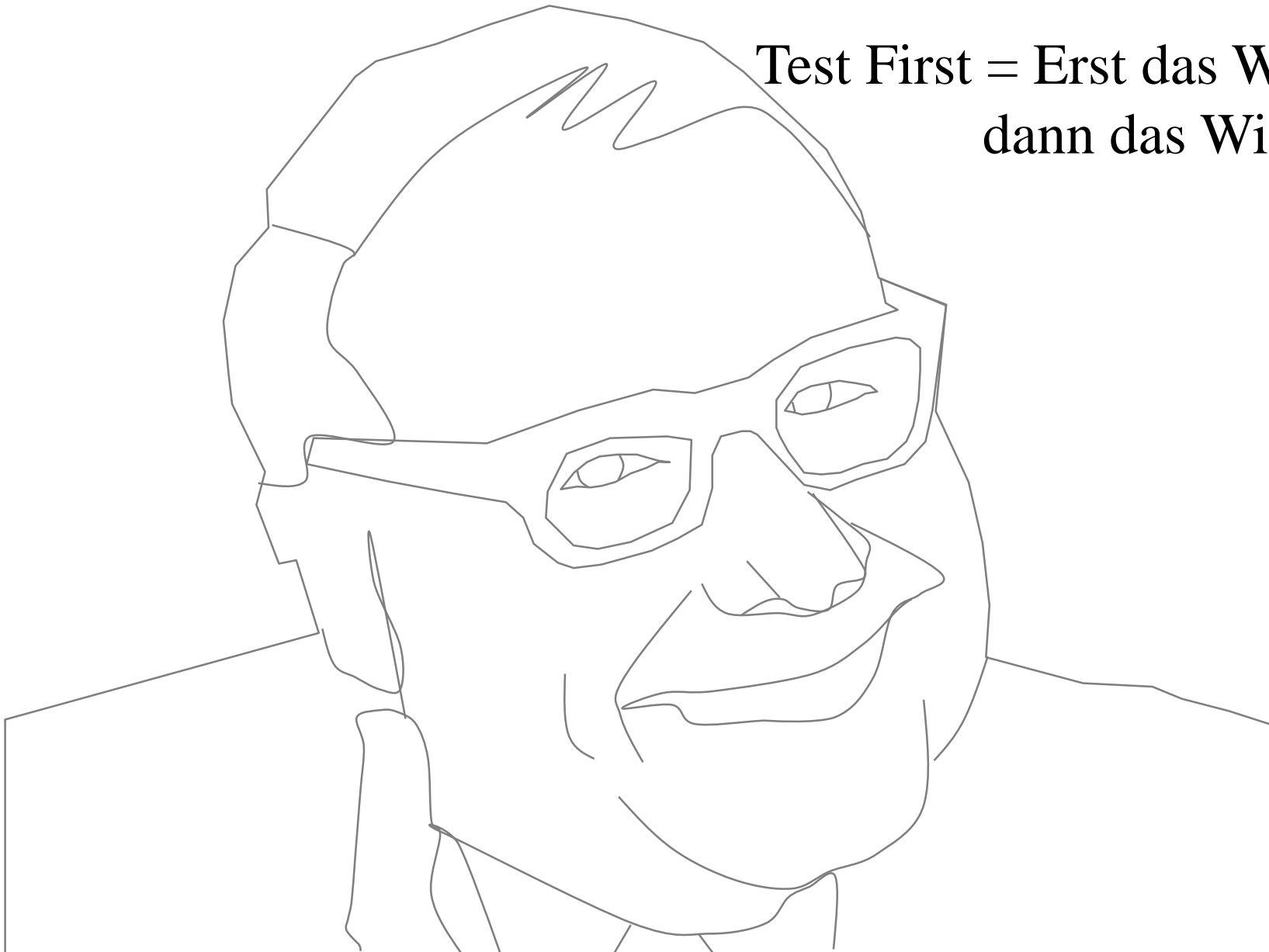
Heinz Erhardt



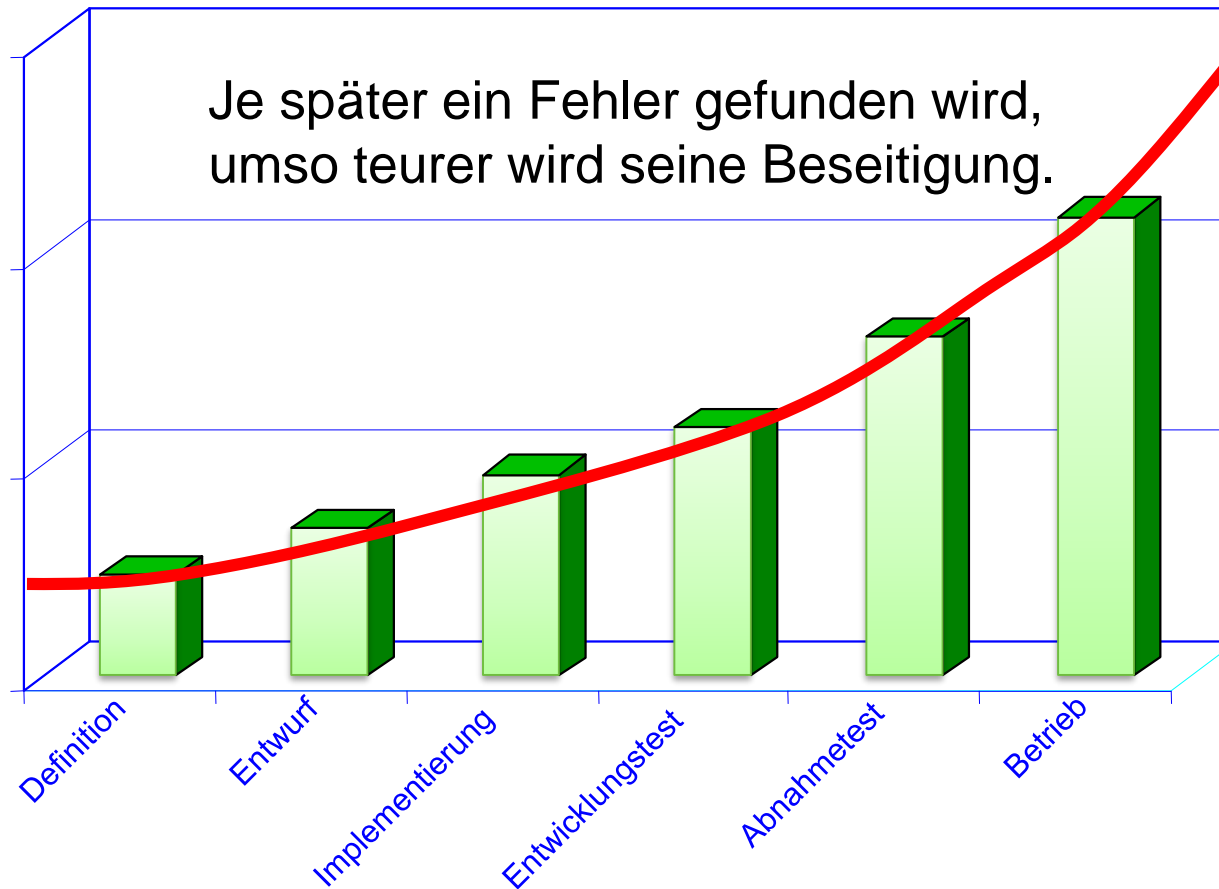
Test First = Erst Testen,
dann Denken?



Test First = Erst das Was Testen,
dann das Wie Denken!



Gründe für den Test-First-Ansatz



 Fehler vermeiden bzw. früh entdecken und beseitigen

Quelle: H. Balzert, 1998; Boehm, 1976

Test-First-Ansatz

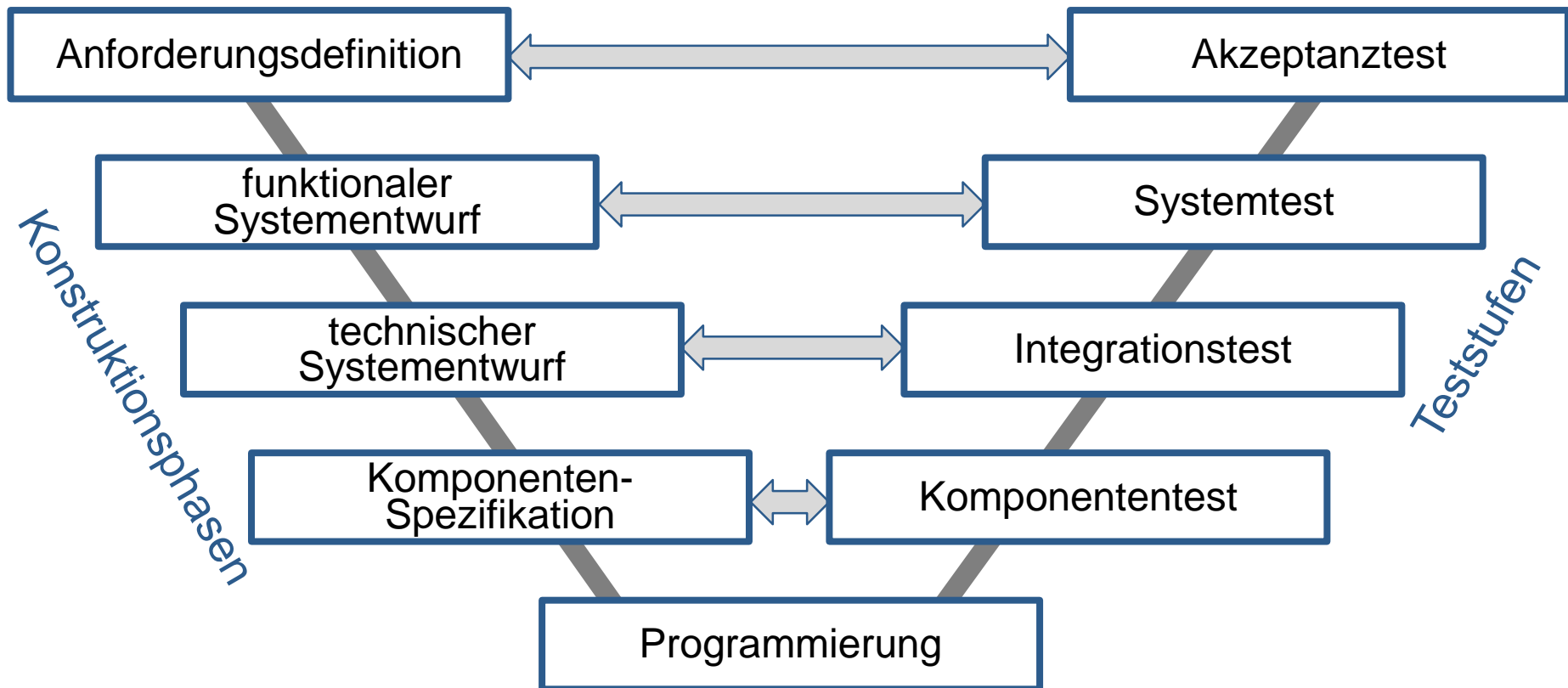
Ziel:

Fehler so früh wie möglich aufdecken

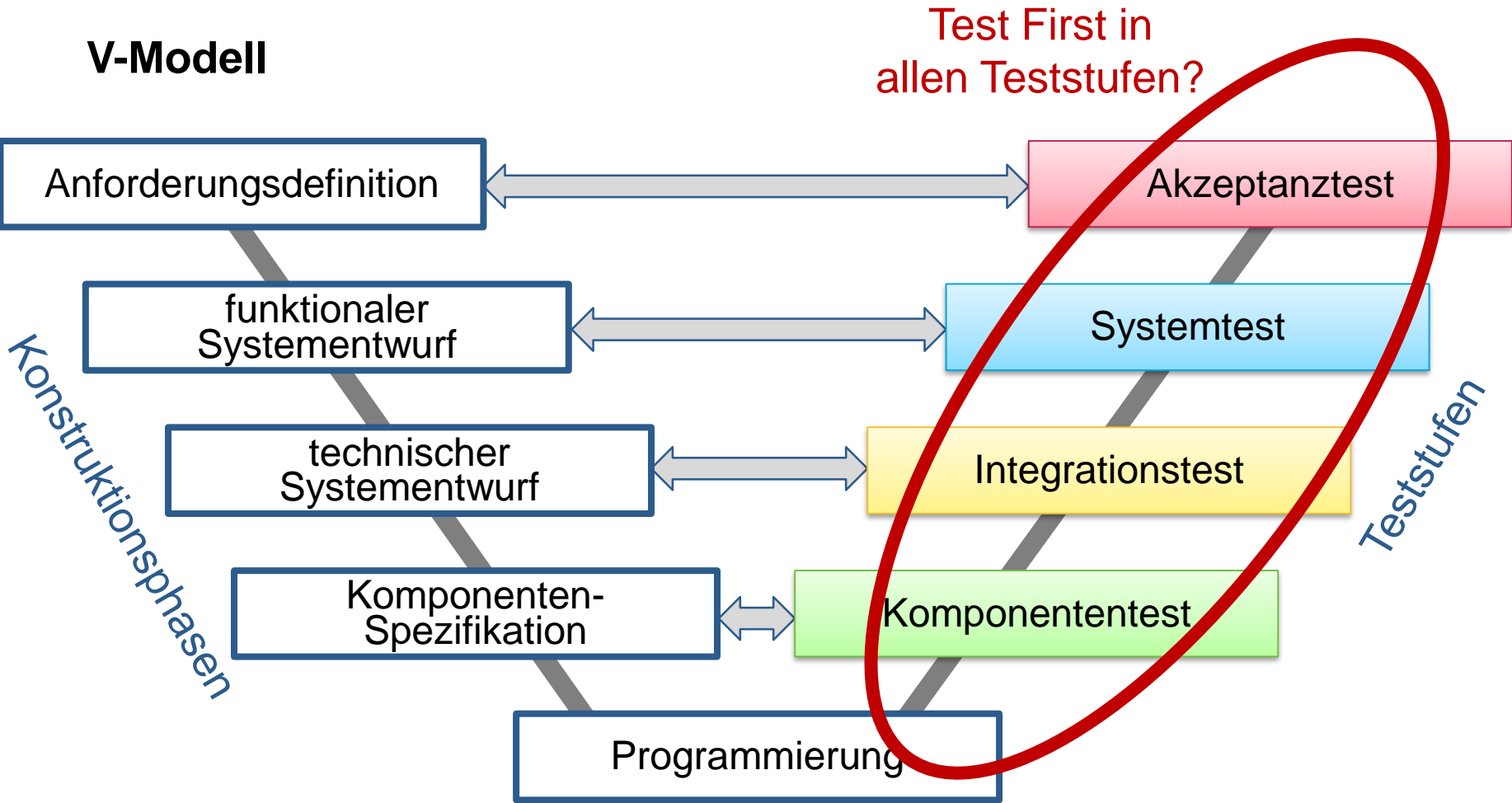
Umsetzung:

- Tests erstellen bevor der jeweilige Testgegenstand existiert
- Tests möglichst früh ausführen
- Test-First lässt sich in allen Teststufen anwenden

V-Modell



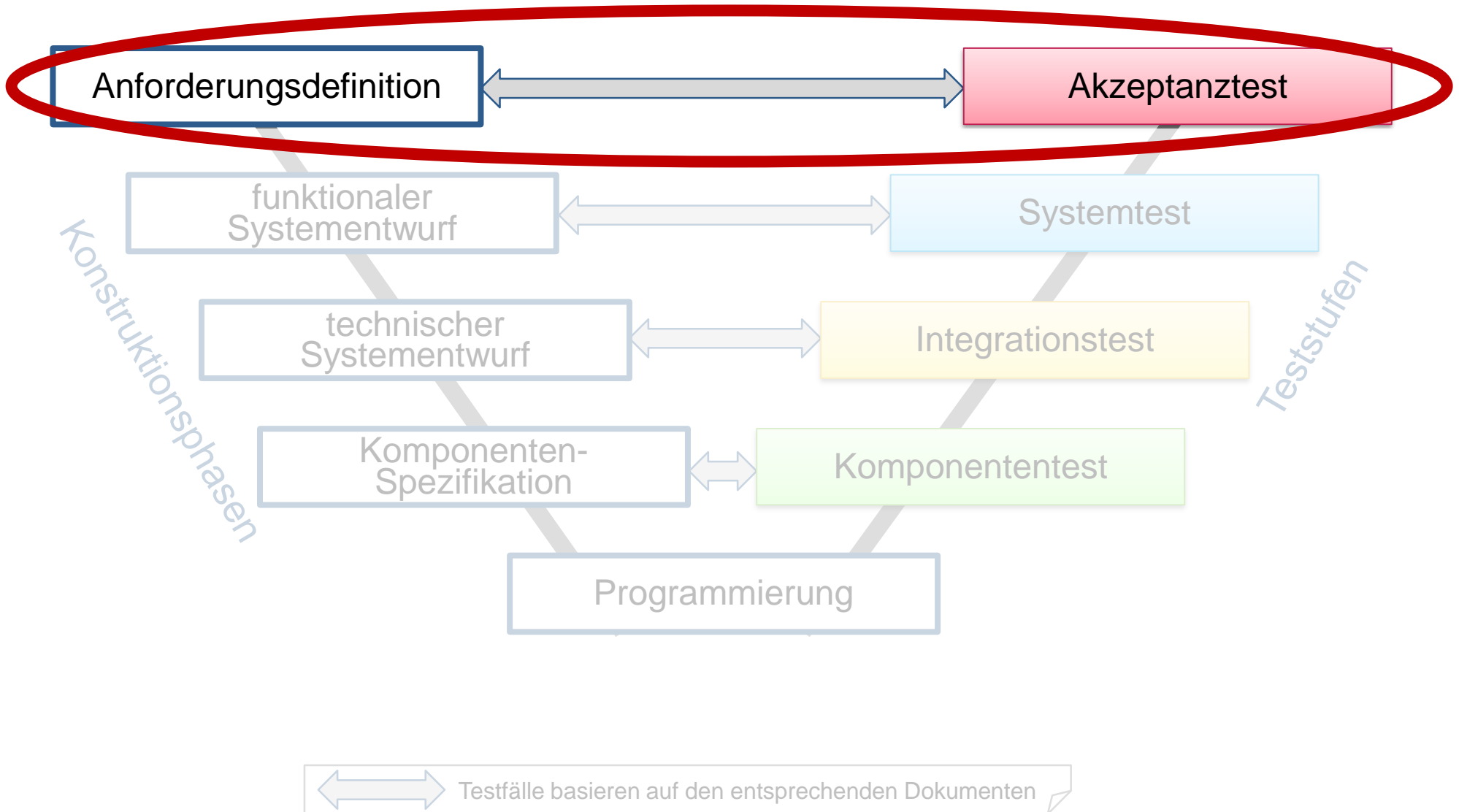
Quelle: V-Modell XT Release 2.3 <http://www.v-modell-xt.de/>



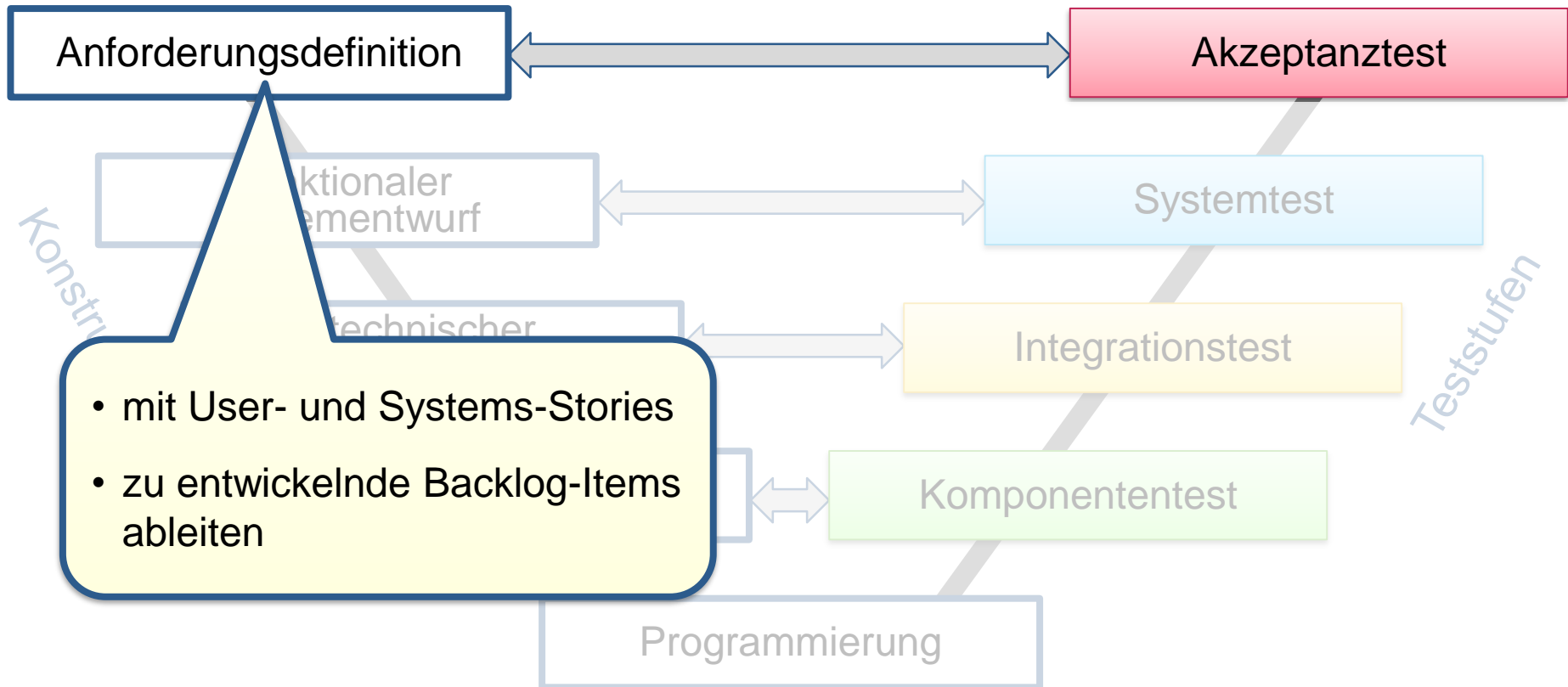
↔ Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Quelle: V-Modell XT Release 2.3 <http://www.v-modell-xt.de/>

Test-First im Akzeptanztest

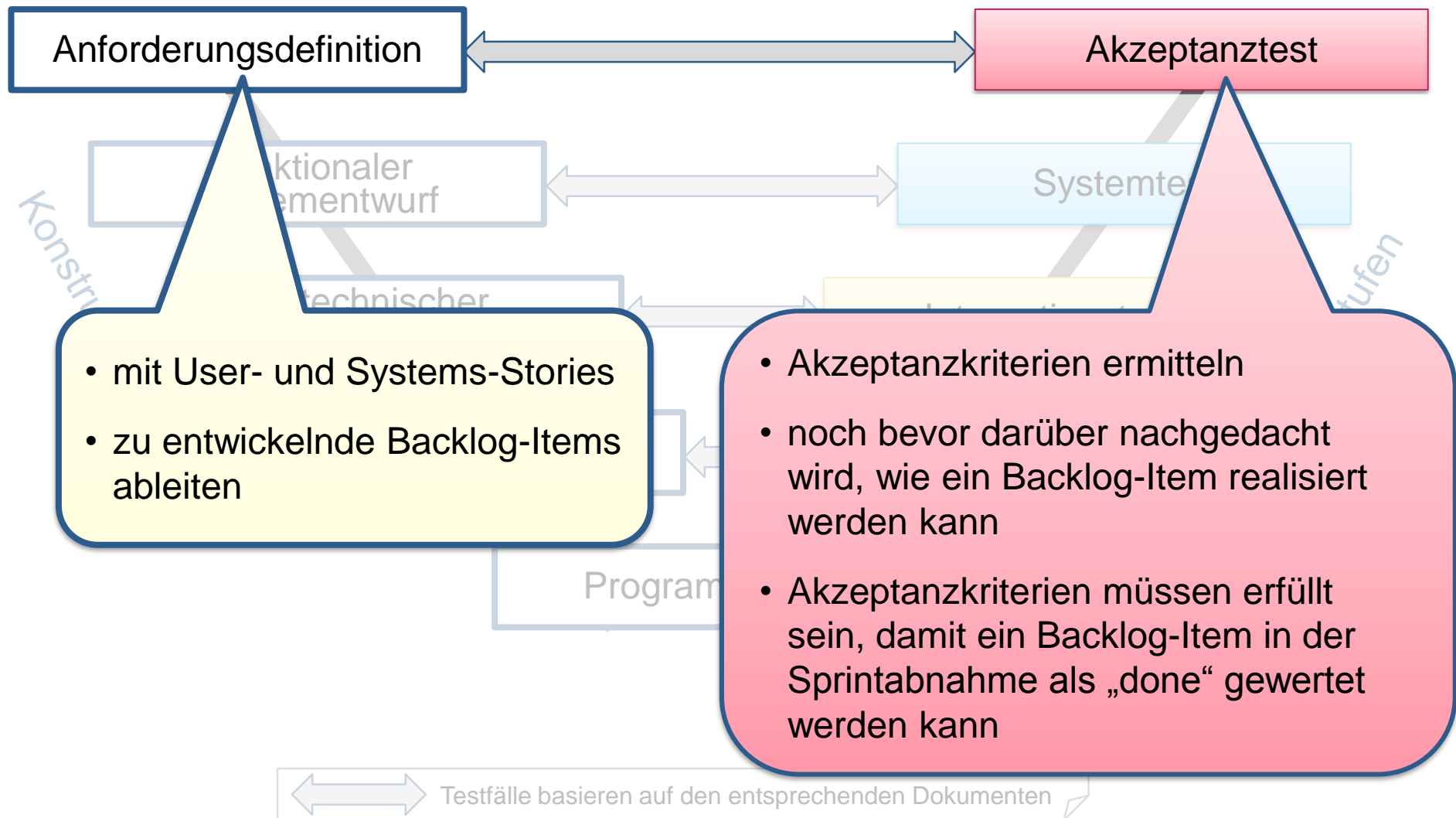


Test-First im Akzeptanztest

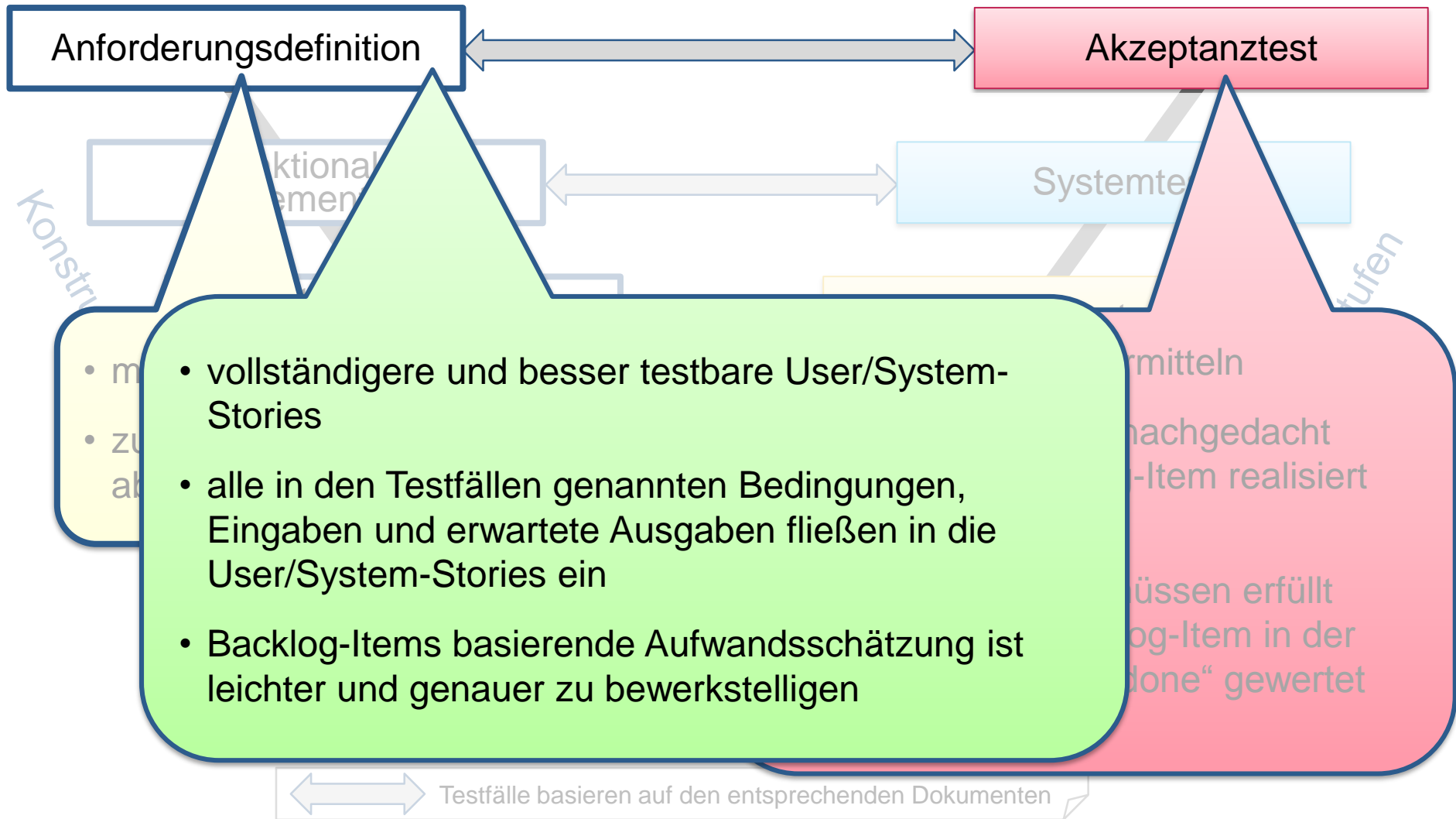


↔ Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

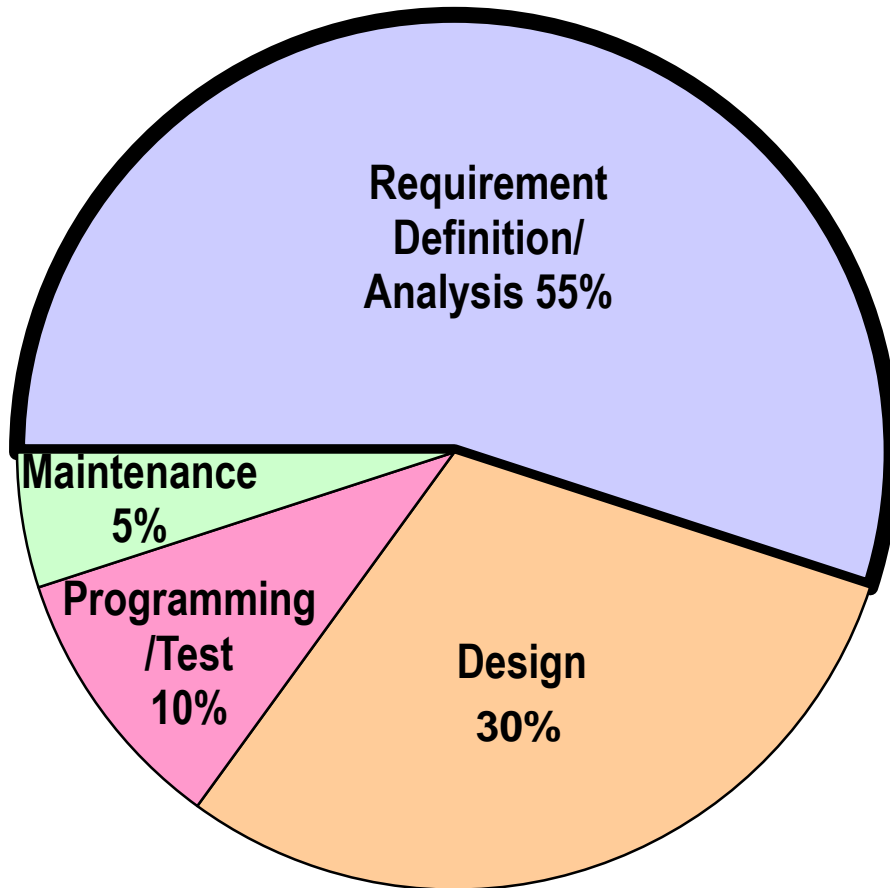
Test-First im Akzeptanztest



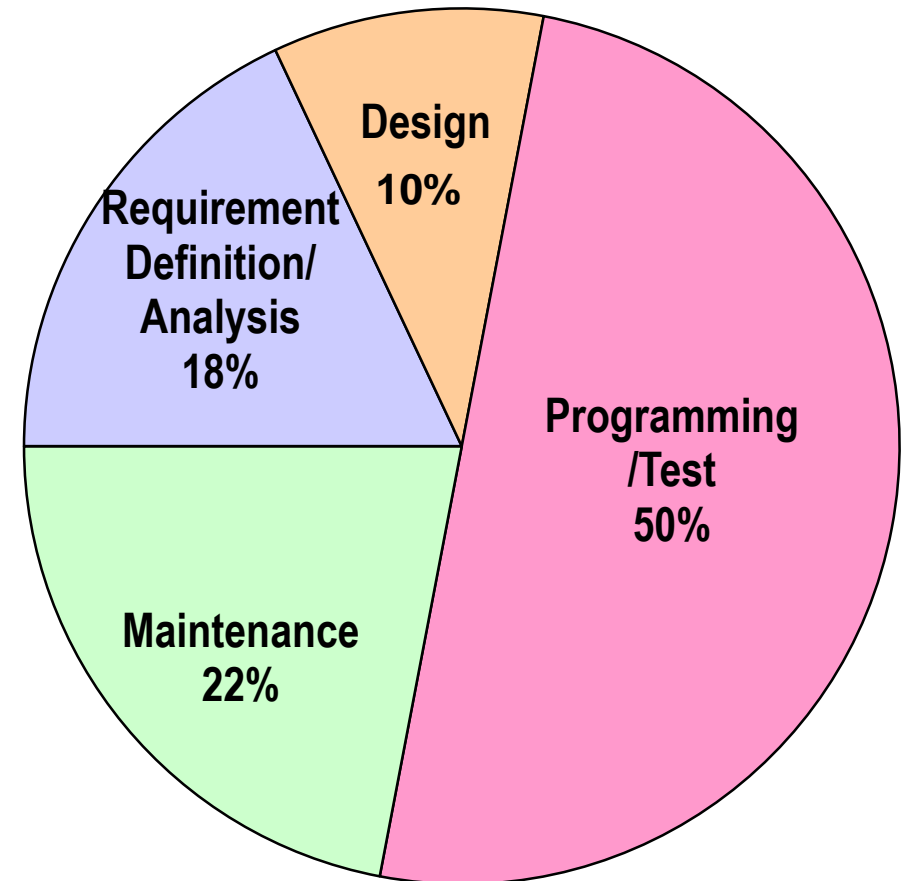
Test-First im Akzeptanztest



Errors Introduced

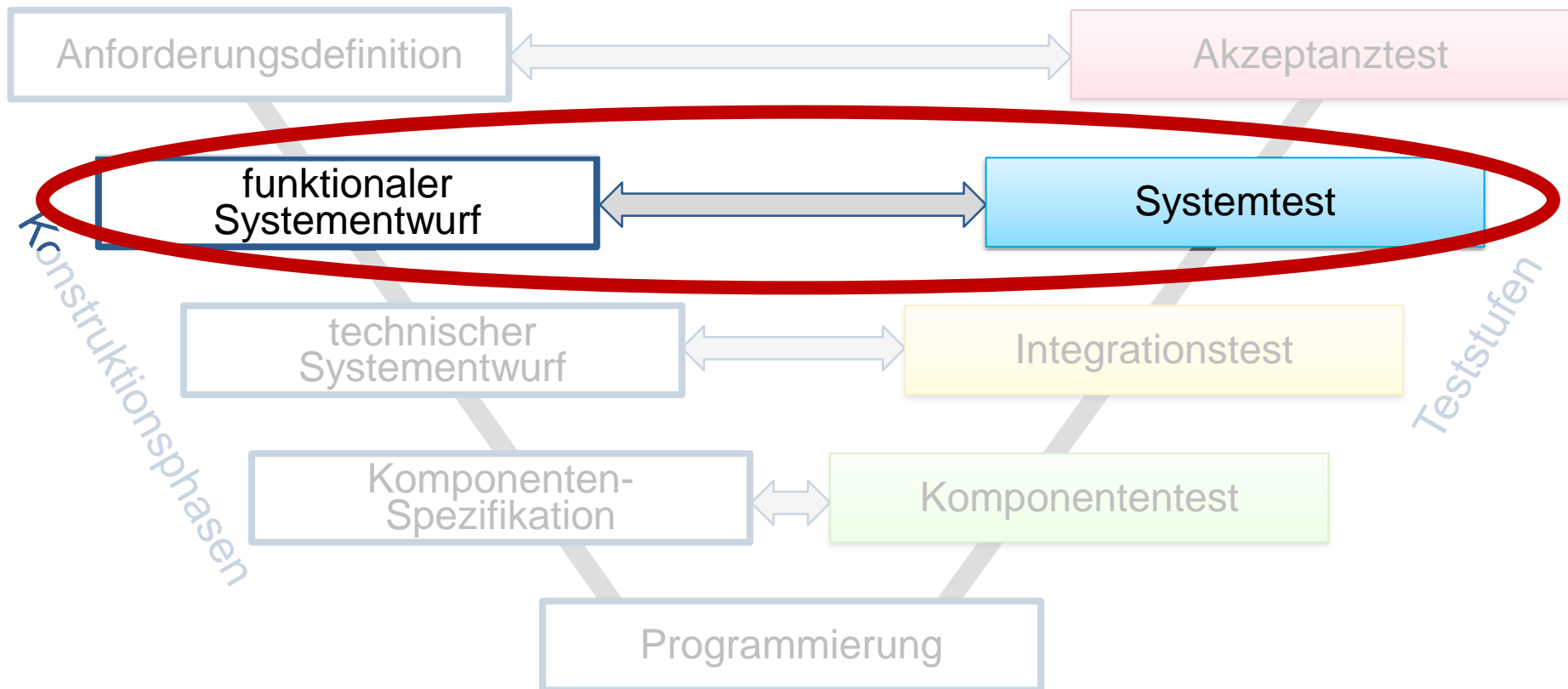


Errors Found



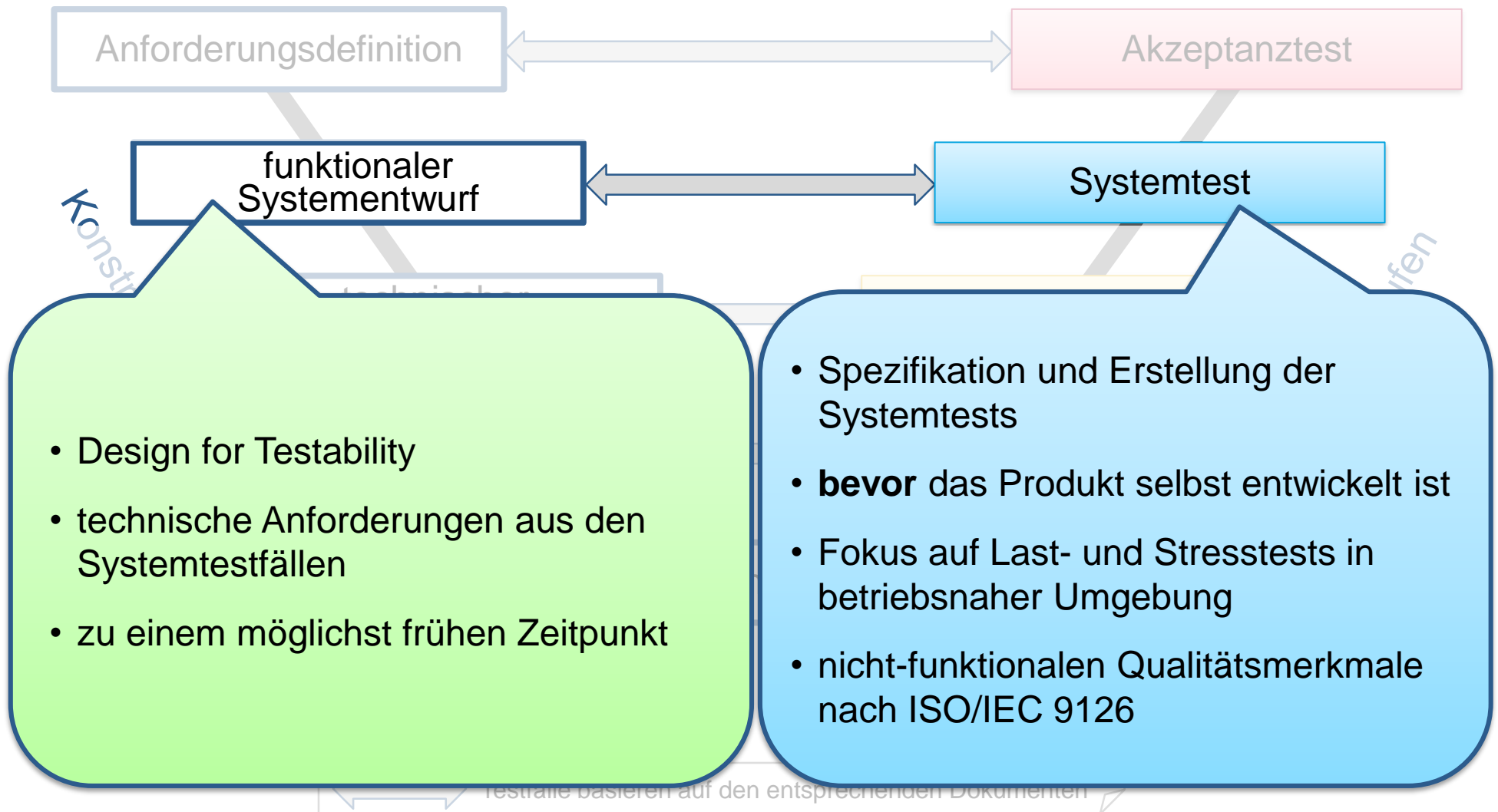
Source: Beltracchi, Leo: Notes on a Means-Ends Requirements Hierarchy. In: Halden Reactor Project HPR-348, Volume I; Loen 1996;
For the data reference is given to: Koss, E.: Developing Reliable Space Flight Software, Las Vegas, Nevada, January 28-30, 1986.

Test-First im Systemtest



Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Test-First im Systemtest



Test-First im Systemtest

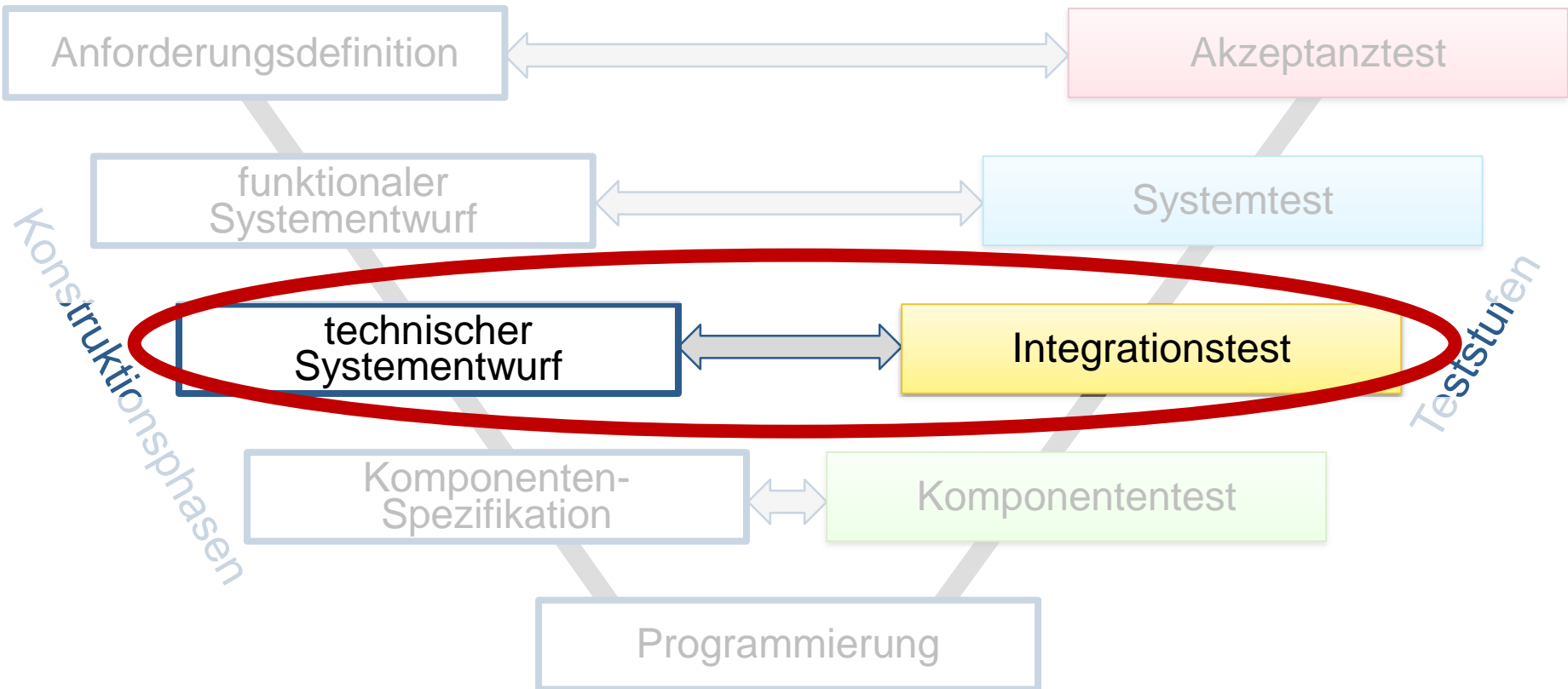
Qualitätsmerkmal	Qualitäts-Teilmerkmal
Funktionalität	Angemessenheit, Richtigkeit, Interoperabilität, Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit
Zuverlässigkeit	Reife, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit
Benutzbarkeit	Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit
Effizienz	Zeitverhalten, Verbrauchsverhalten
Änderbarkeit	Analysierbarkeit, Modifizierbarkeit, Stabilität, Prüfbarkeit
Übertragbarkeit	Anpaßbarkeit, Installierbarkeit, Konformität, Austauschbarkeit

- D
- te
- Sy
- zu einem möglichst frühen Zeitpunkt

- nicht-funktionale Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 9126

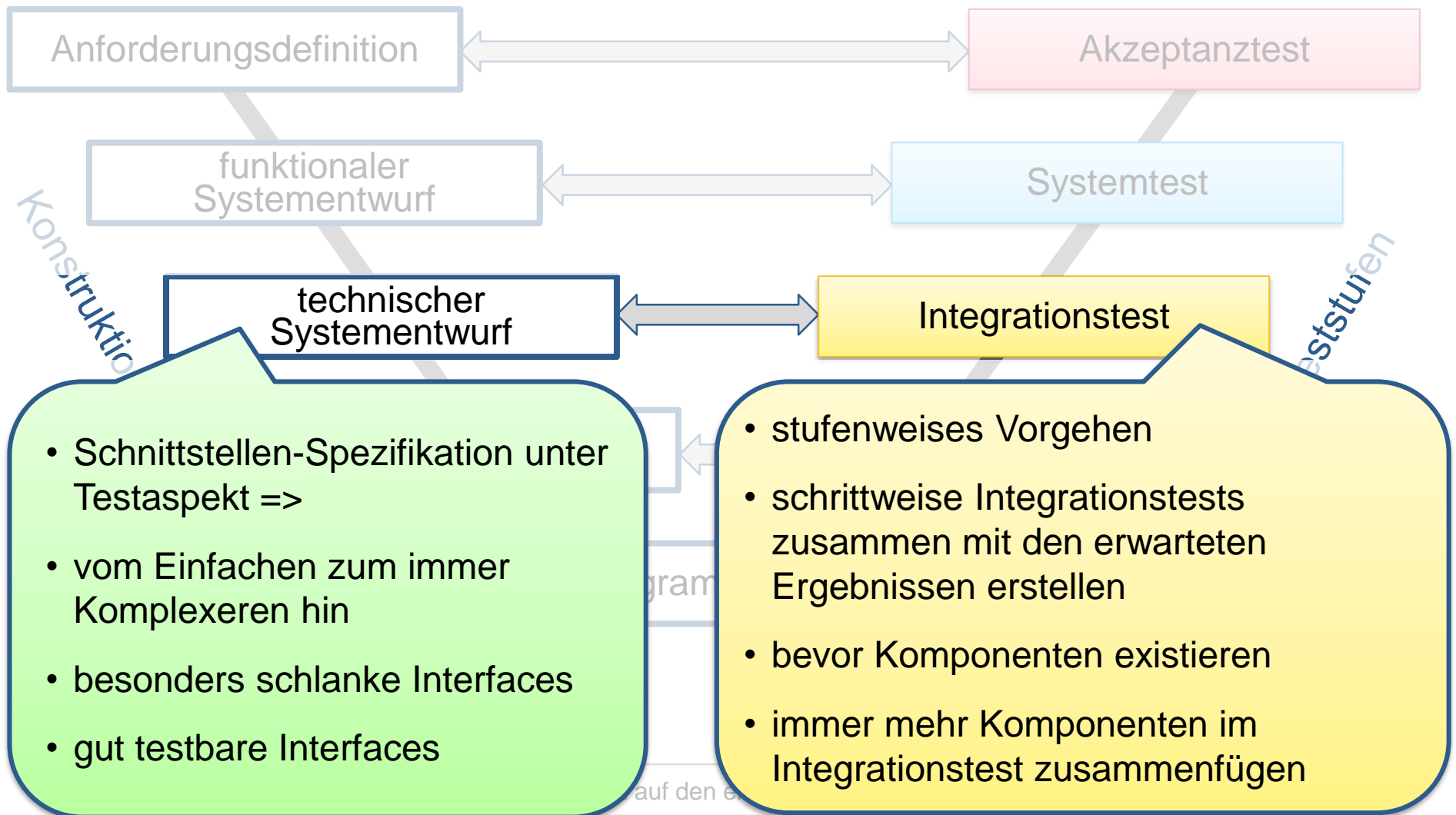
Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Test-First im Integrationstest

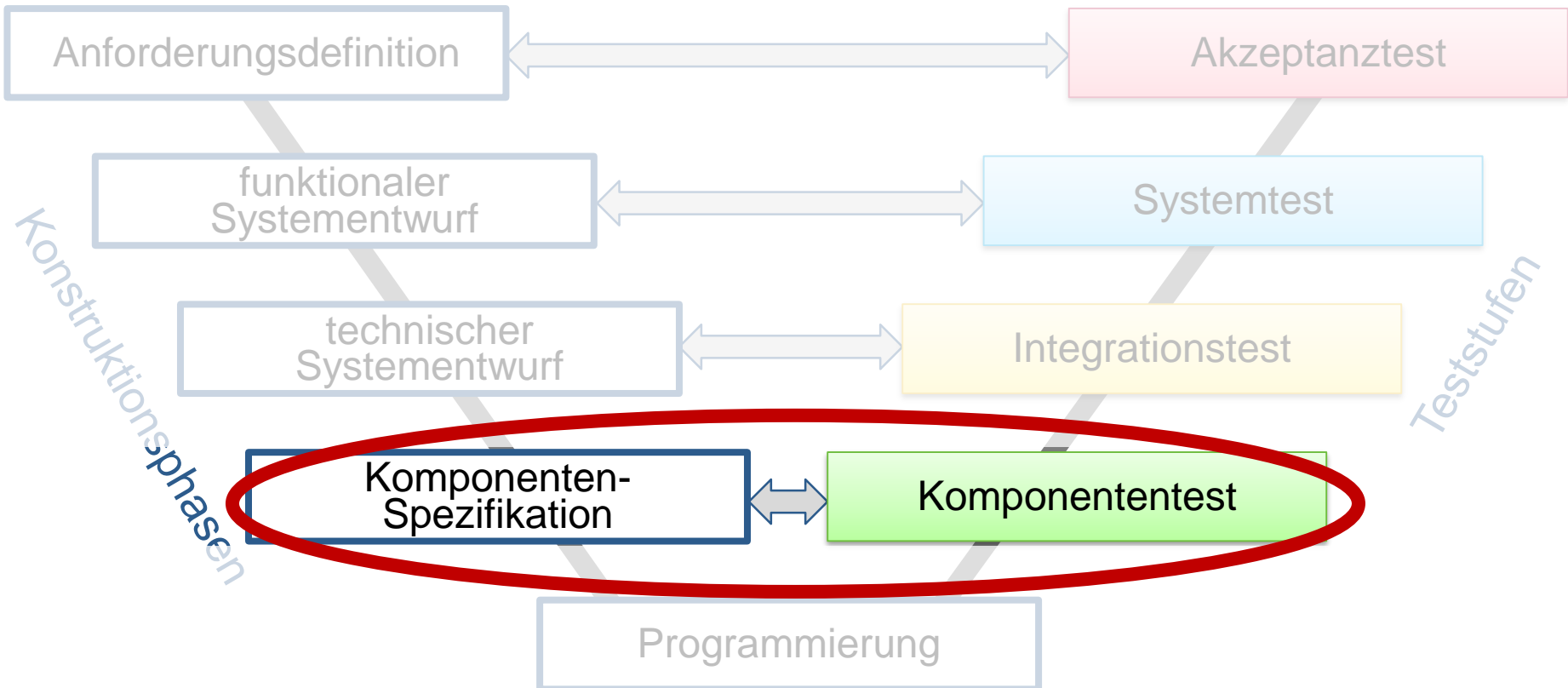


↔ Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Test-First im Integrationstest

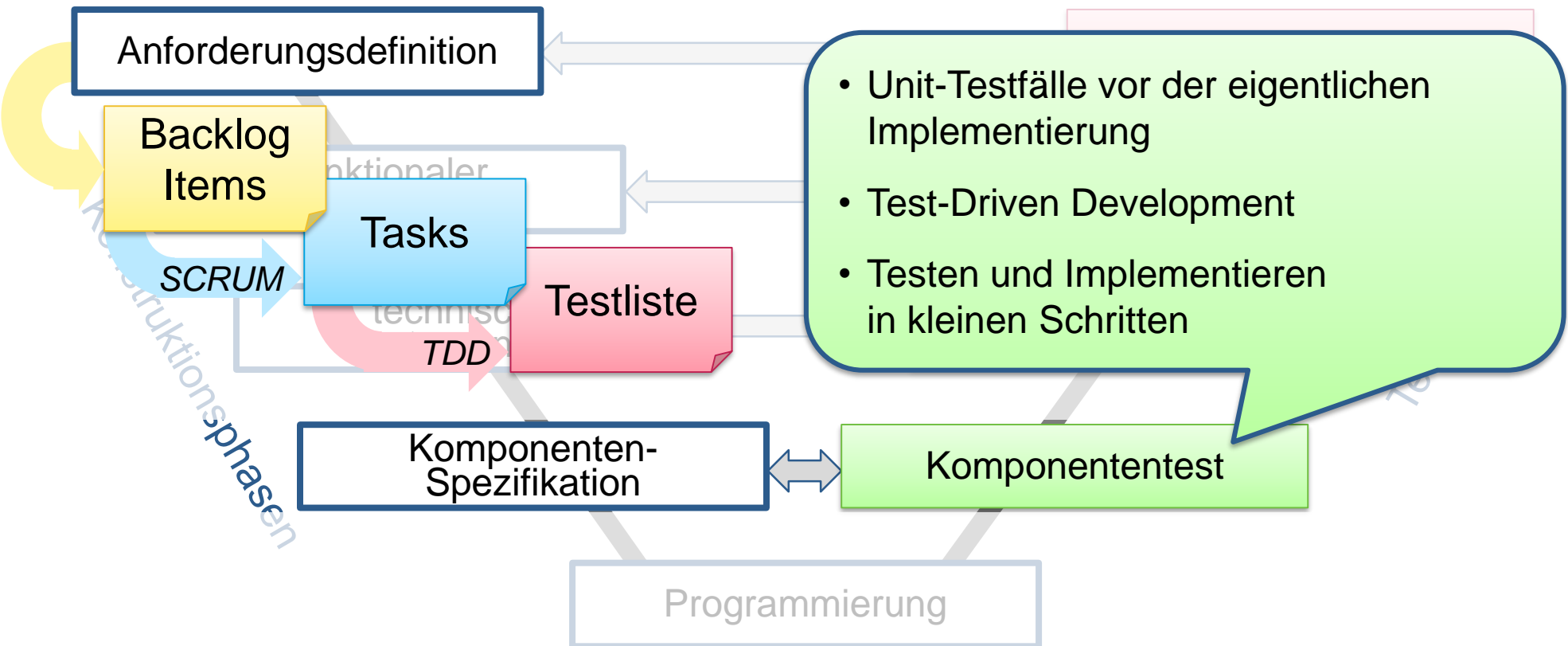


Test-First im Komponententest

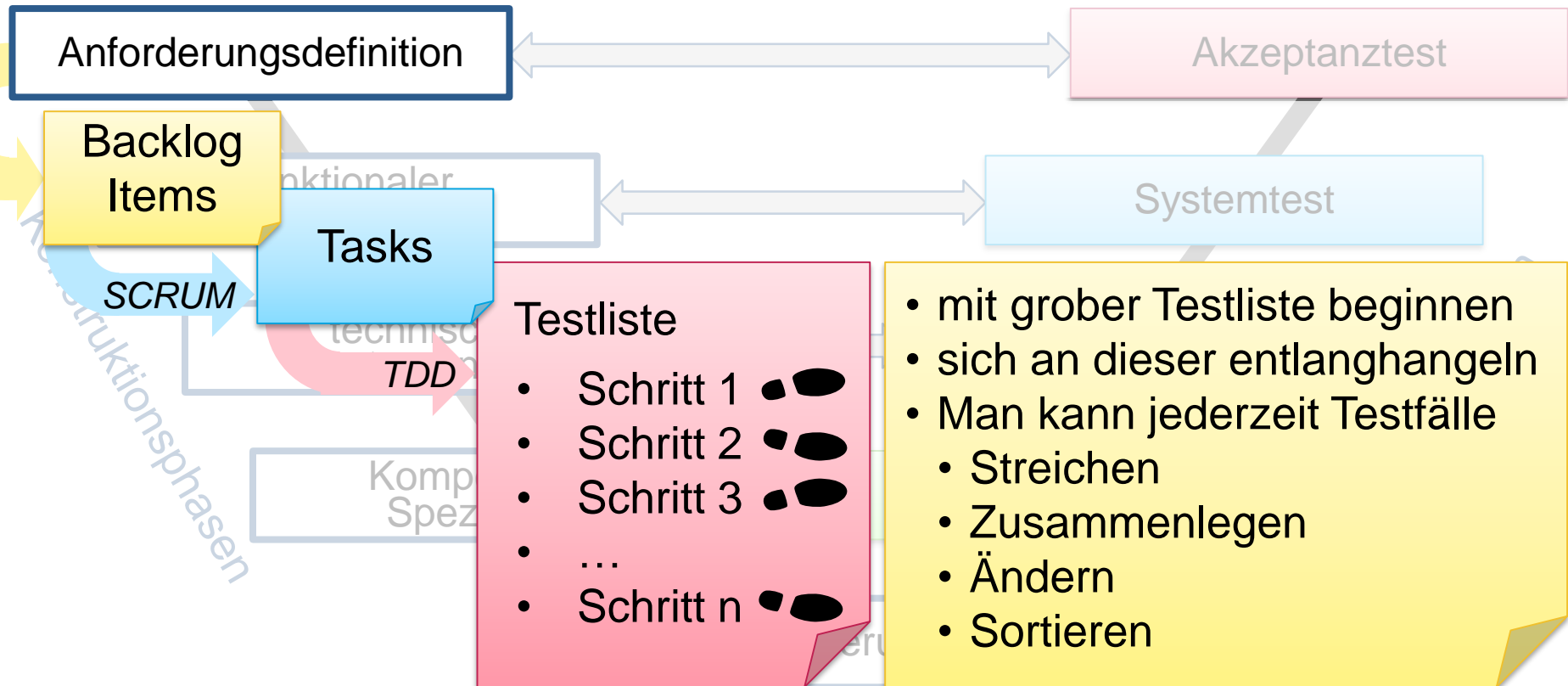


↔ Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Test-First im Komponententest



Test-First im Komponententest



Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Test-First im Komponententest

Iterative Code Entwicklung anhand automatisierter Testfälle



SCRUM

technische Spezifikation
TDD

Testliste

- Schritt 1
- Schritt 2
- Schritt 3
- ...
- Schritt n

Integrationstest

Komponententest

Implementierung

Testfälle basieren auf den entsprechenden Dokumenten

Beispiel Testliste

Anforderungsdefinition

Backlog
Items

Tasks

SCRUM

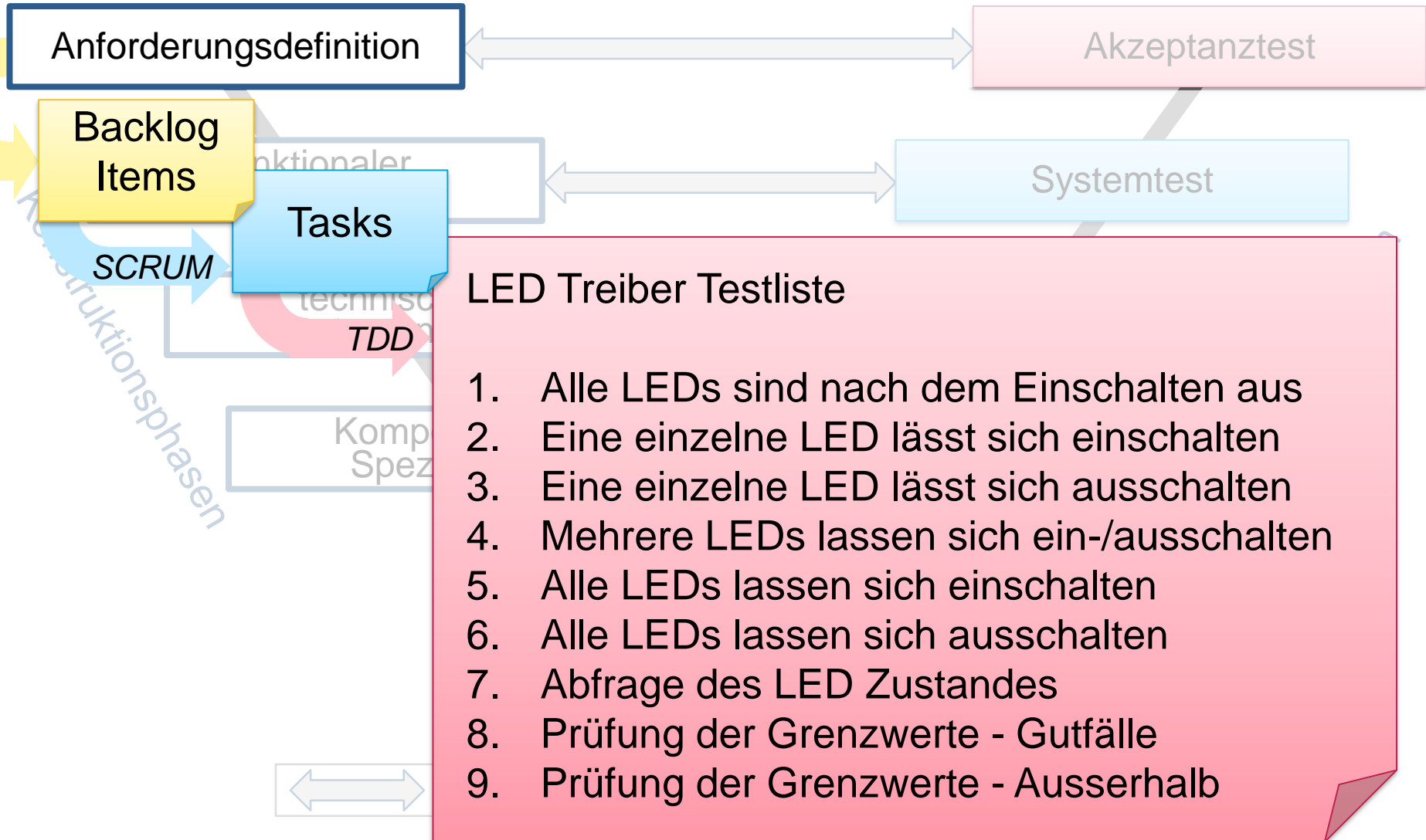
TDD

Komp
Spez

LED Driver Beispiel

- 8 LEDs zur Statusanzeige
- Einzelne LED an/aus schalten
- Abfrage des Status jeder LED
- Initialisierung aller LEDs auf den Zustand aus
- Memory mapping der LEDs auf eine 8-bit RAM Zelle
- „1“ an bit-Position n bedeutet LEDn=an, „0“ bedeutet aus
- Das niederwertigste bit (LSB) korrespondiert mit LED1
- Das höchstwertige bit (MSB) korrespondiert mit LED8

Beispiel Testliste



LED Treiber Testliste

1. Alle LEDs sind nach dem Einschalten aus
2. Eine einzelne LED lässt sich einschalten
3. Eine einzelne LED lässt sich ausschalten
4. Mehrere LEDs lassen sich ein-/ausschalten
5. Alle LEDs lassen sich einschalten
6. Alle LEDs lassen sich ausschalten
7. Abfrage des LED Zustandes
8. Prüfung der Grenzwerte - Gutfälle
9. Prüfung der Grenzwerte - Ausserhalb

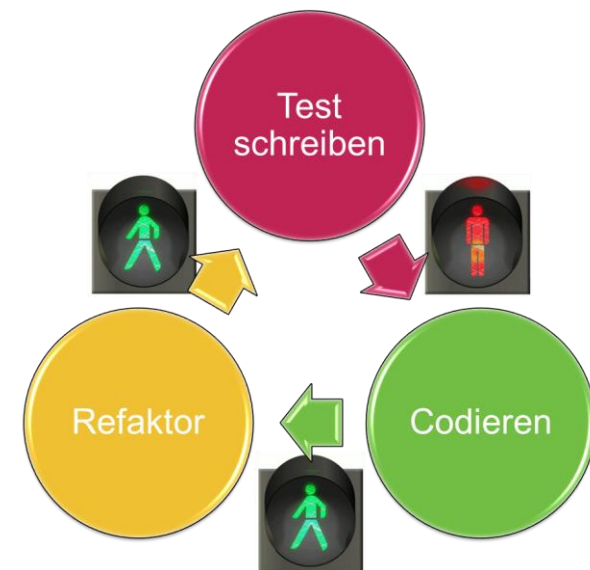
Quelle: James W. Grenning, Test-Driven Development for Embedded C

Test-Driven Development

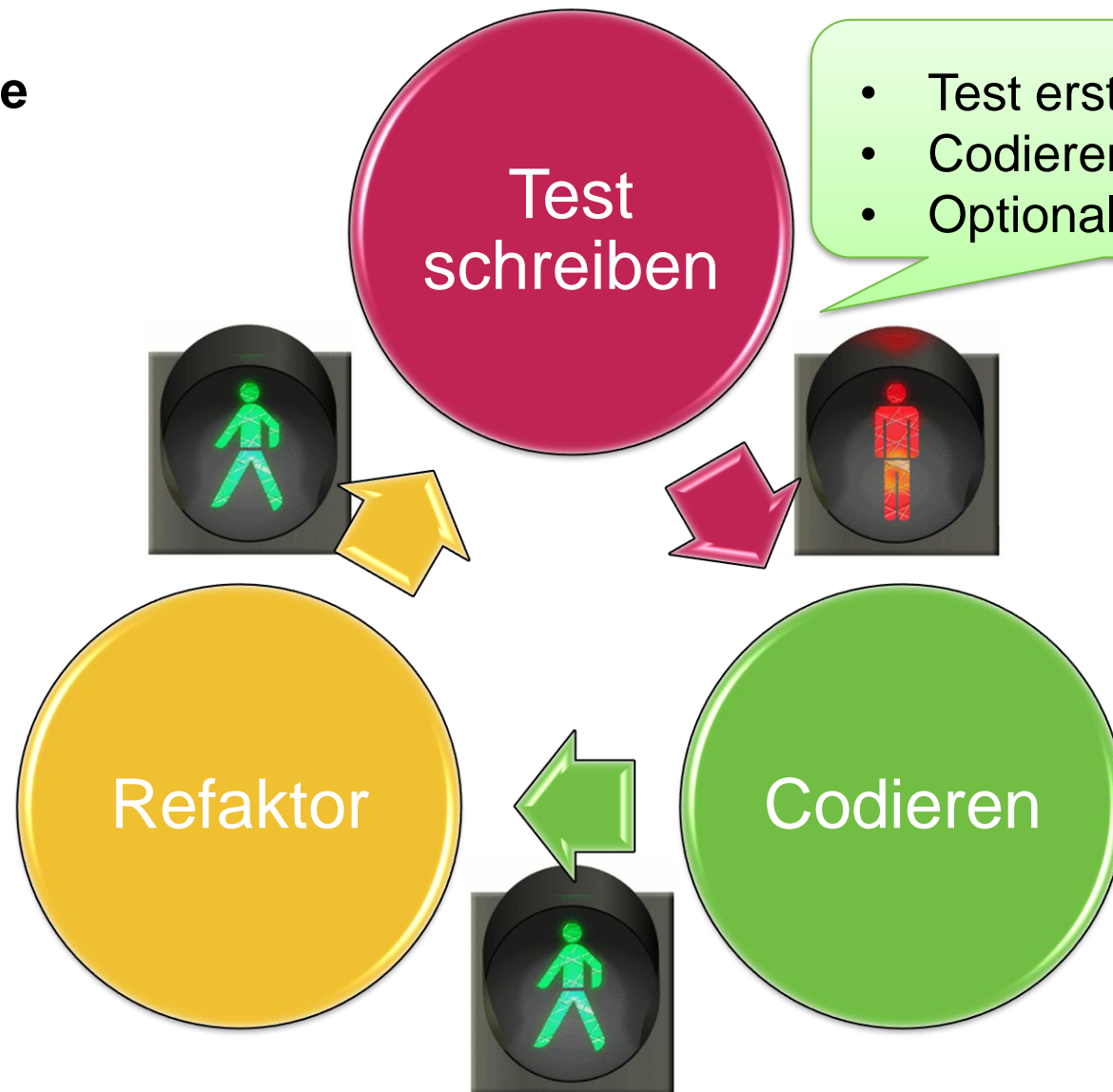
Iterative Code Entwicklung anhand automatisierter Testfälle



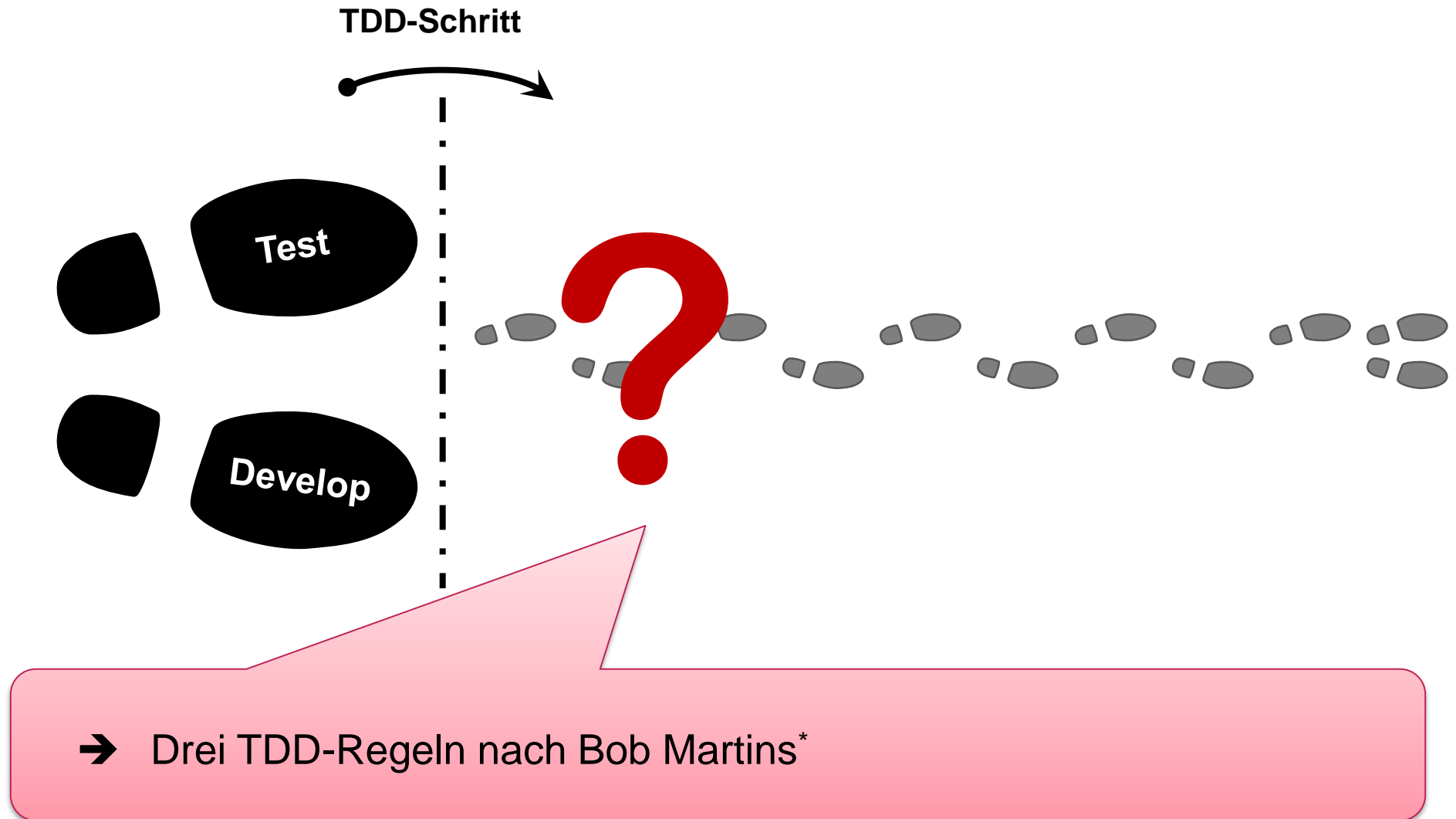
Jeder inkrementelle Schritt besteht aus einer Iteration des **TDD-Cycles**:



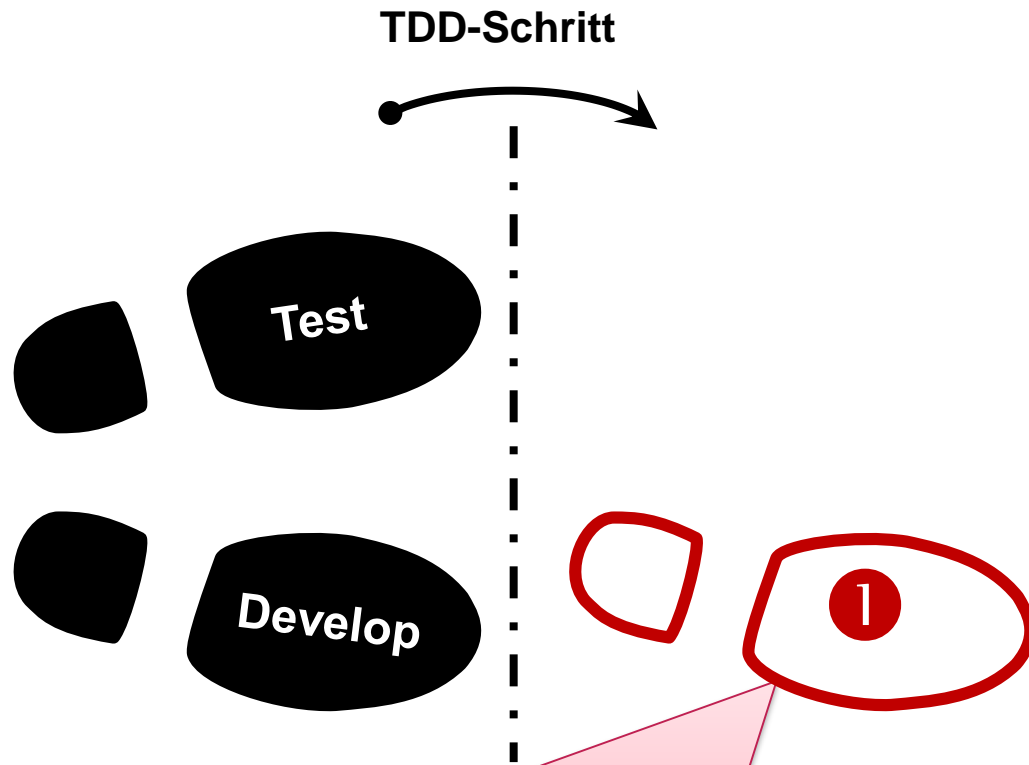
TDD-Cycle



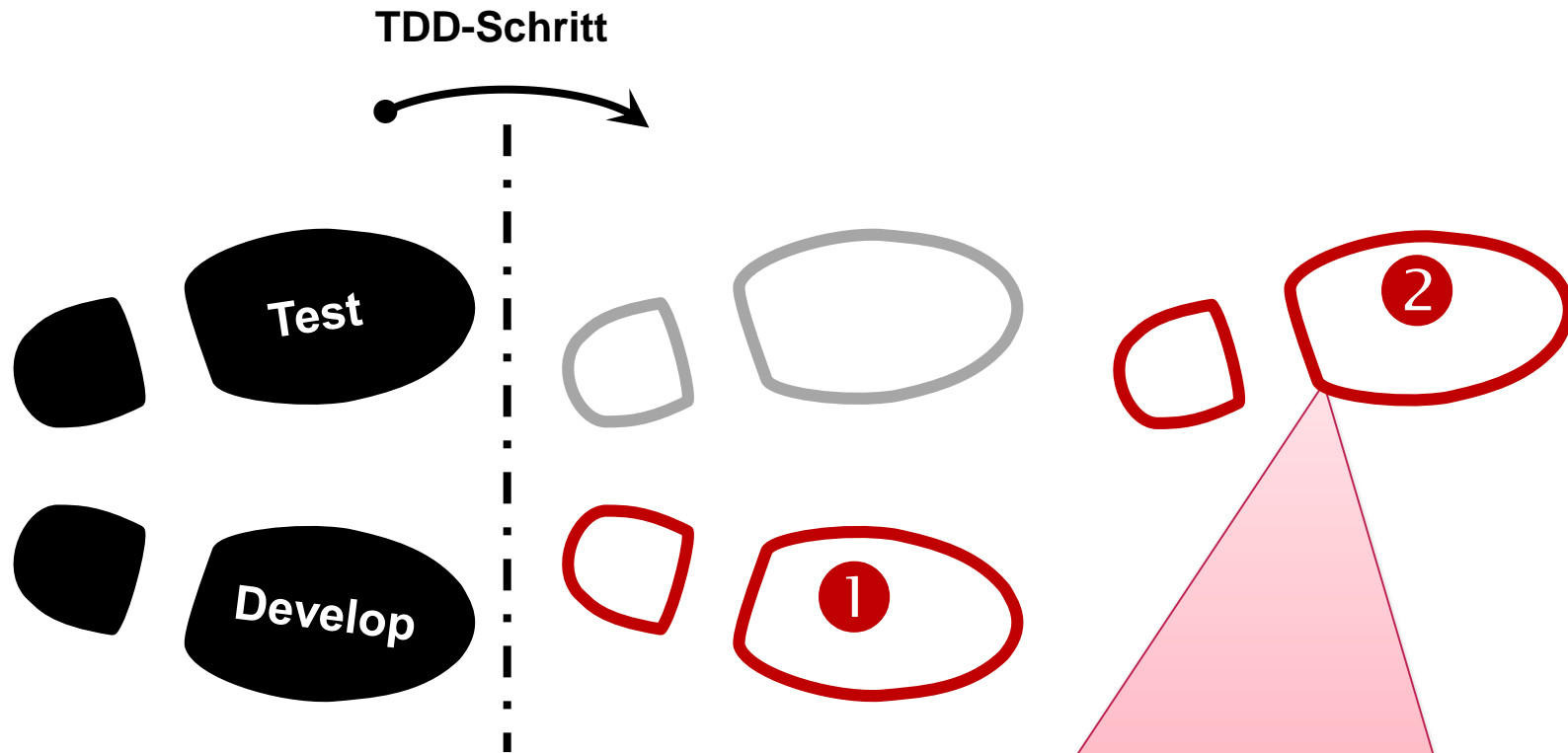
=> Anzahl der Tests wächst mit jedem Cycle kontinuierlich an



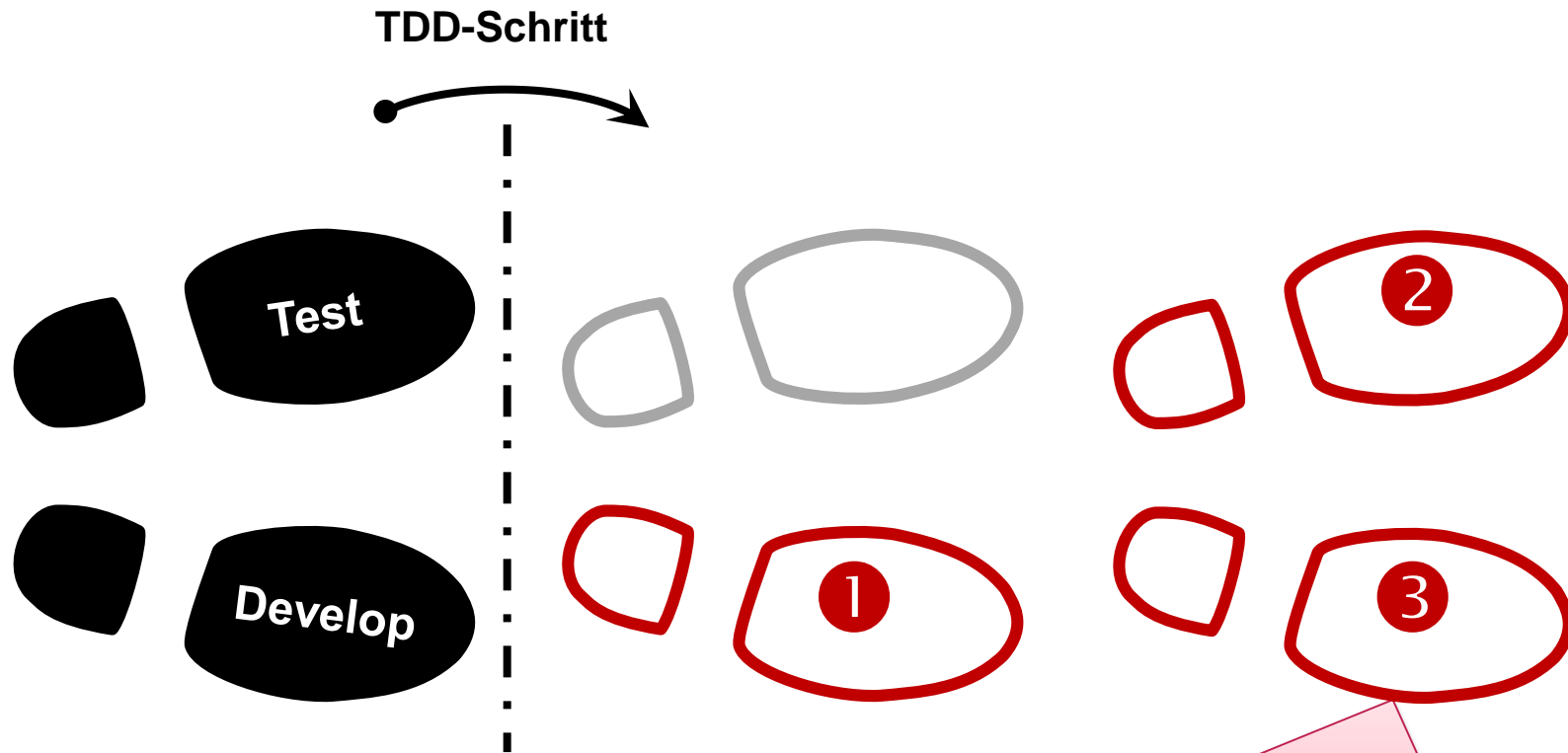
*) <http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheThreeRulesOfTdd>



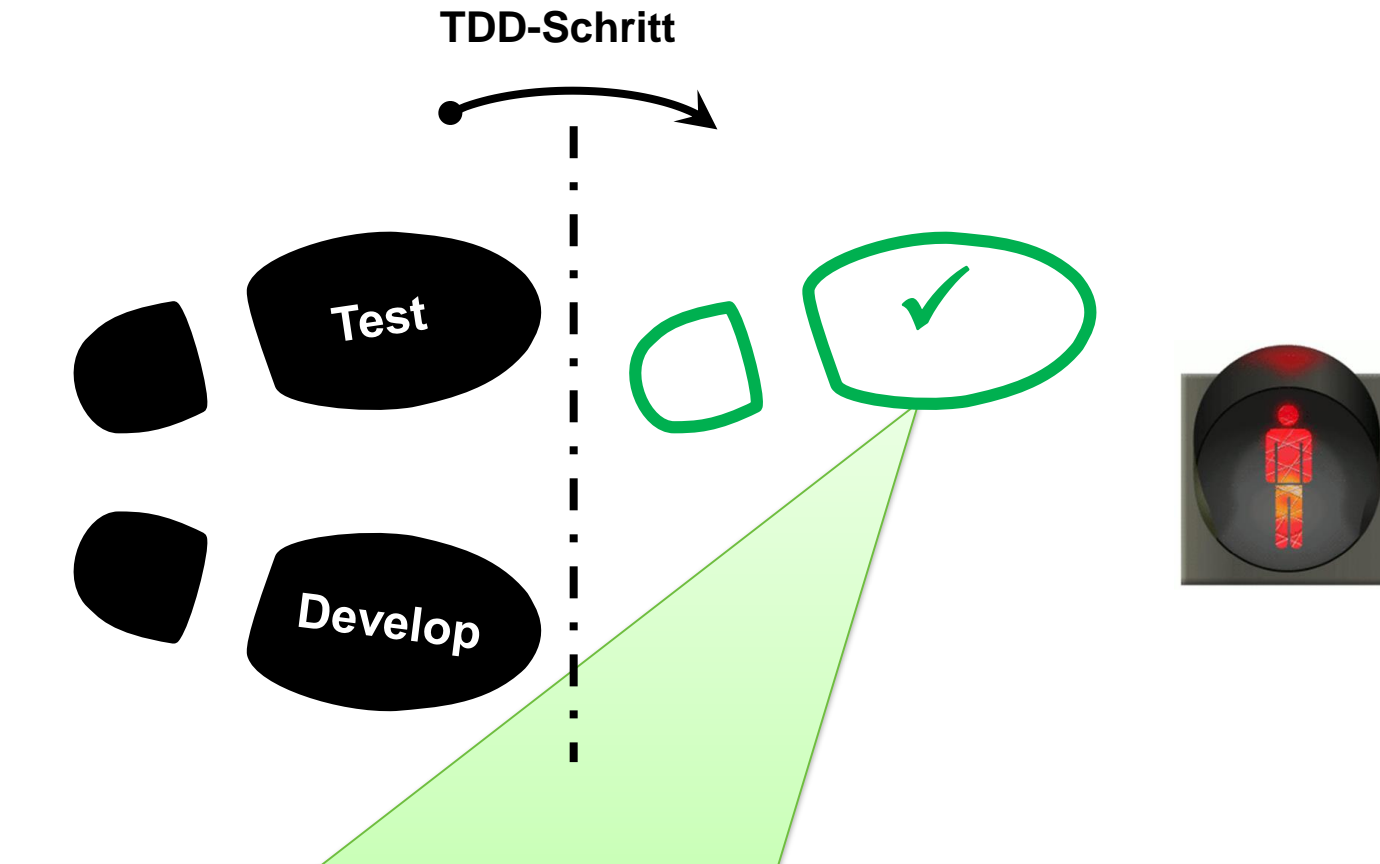
1. Schreibe keinen Code solange dieser nicht zur erfolgreichen Durchführung eines Testfalls erforderlich ist.

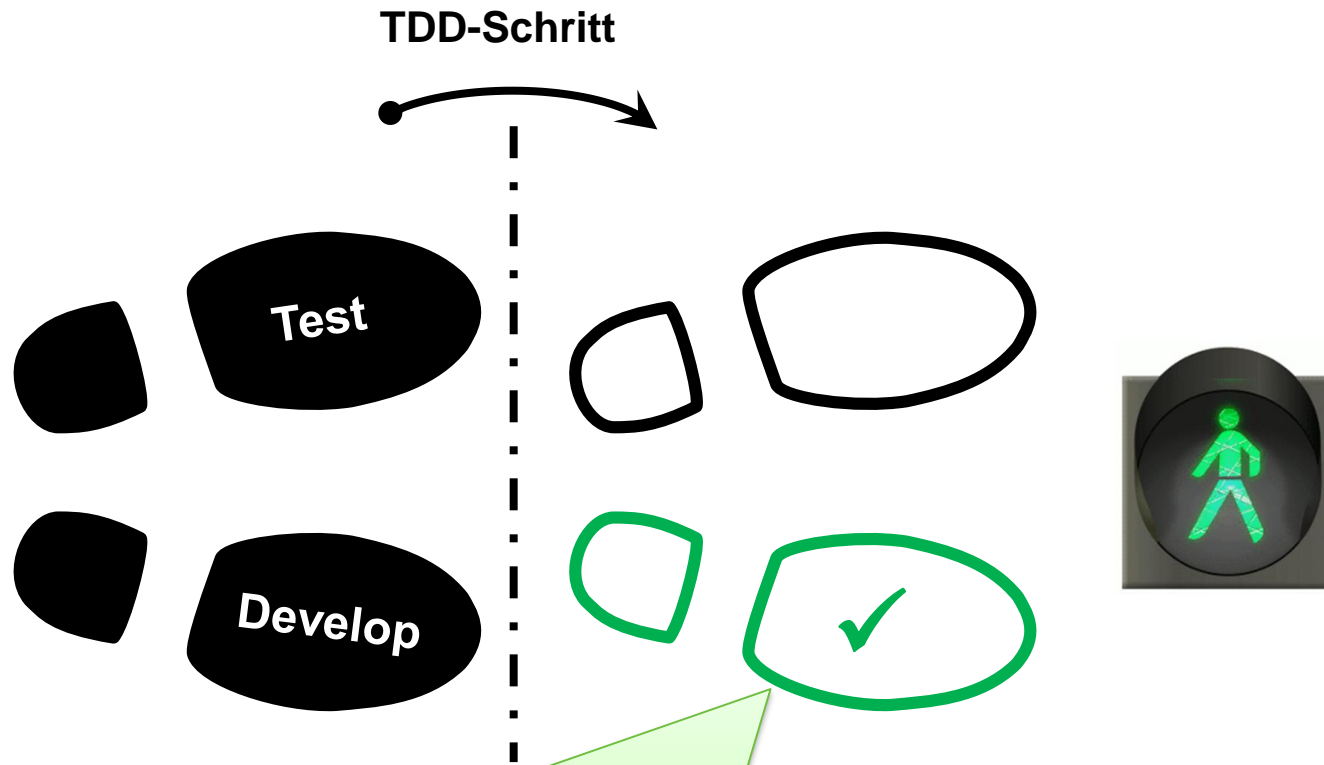


2. Begrenze den Umfang eines Unit-Testfalls darauf fehl zu schlagen. Auch Compiler-/Linker-Fehler sind Fehler.

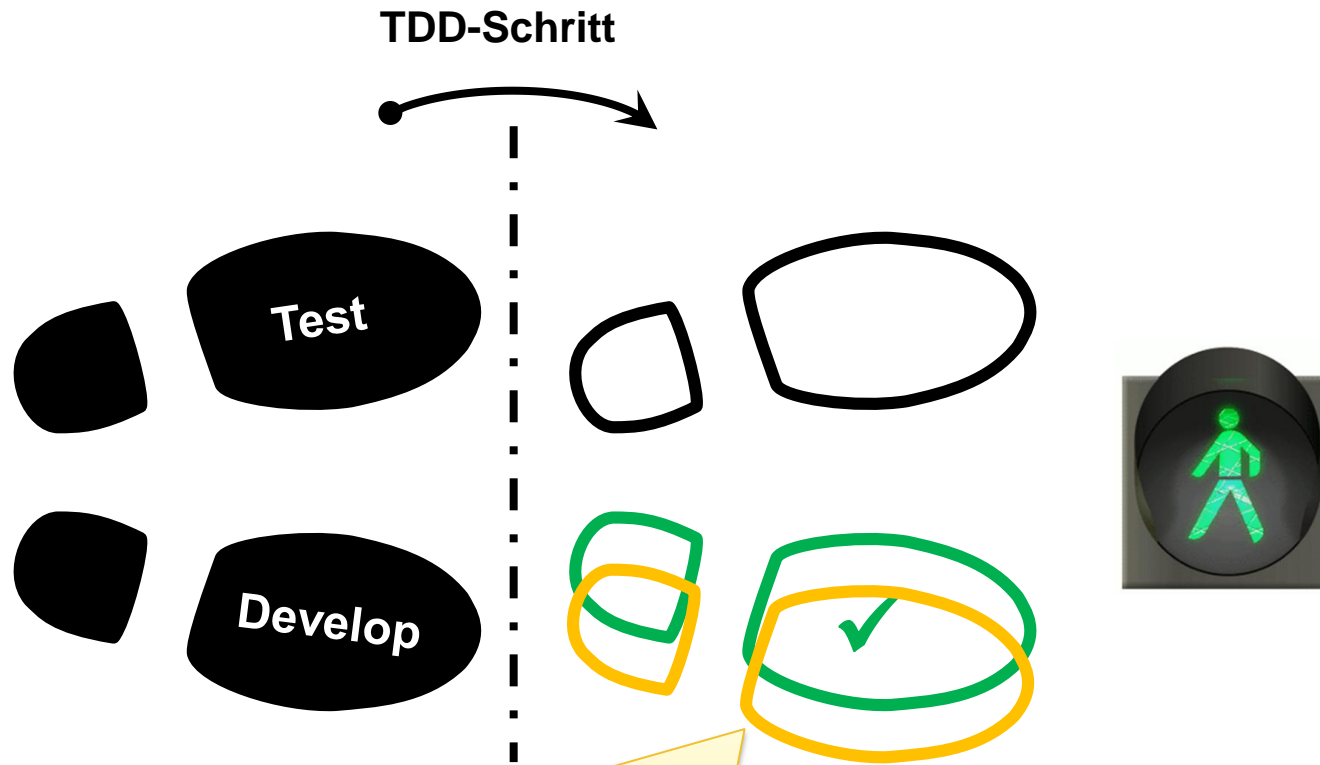


3. Schreibe nicht mehr Code, als erforderlich ist, um den aktuellen Unit-Testfall zu bestehen.

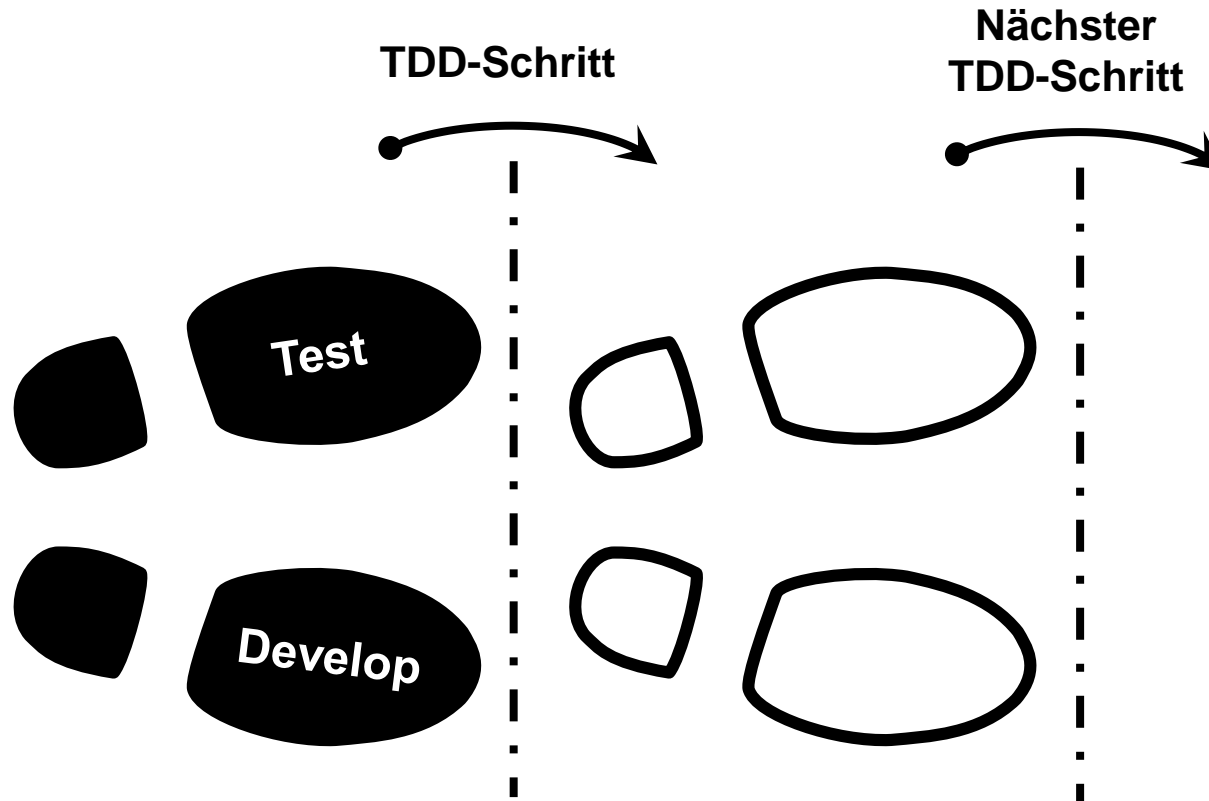




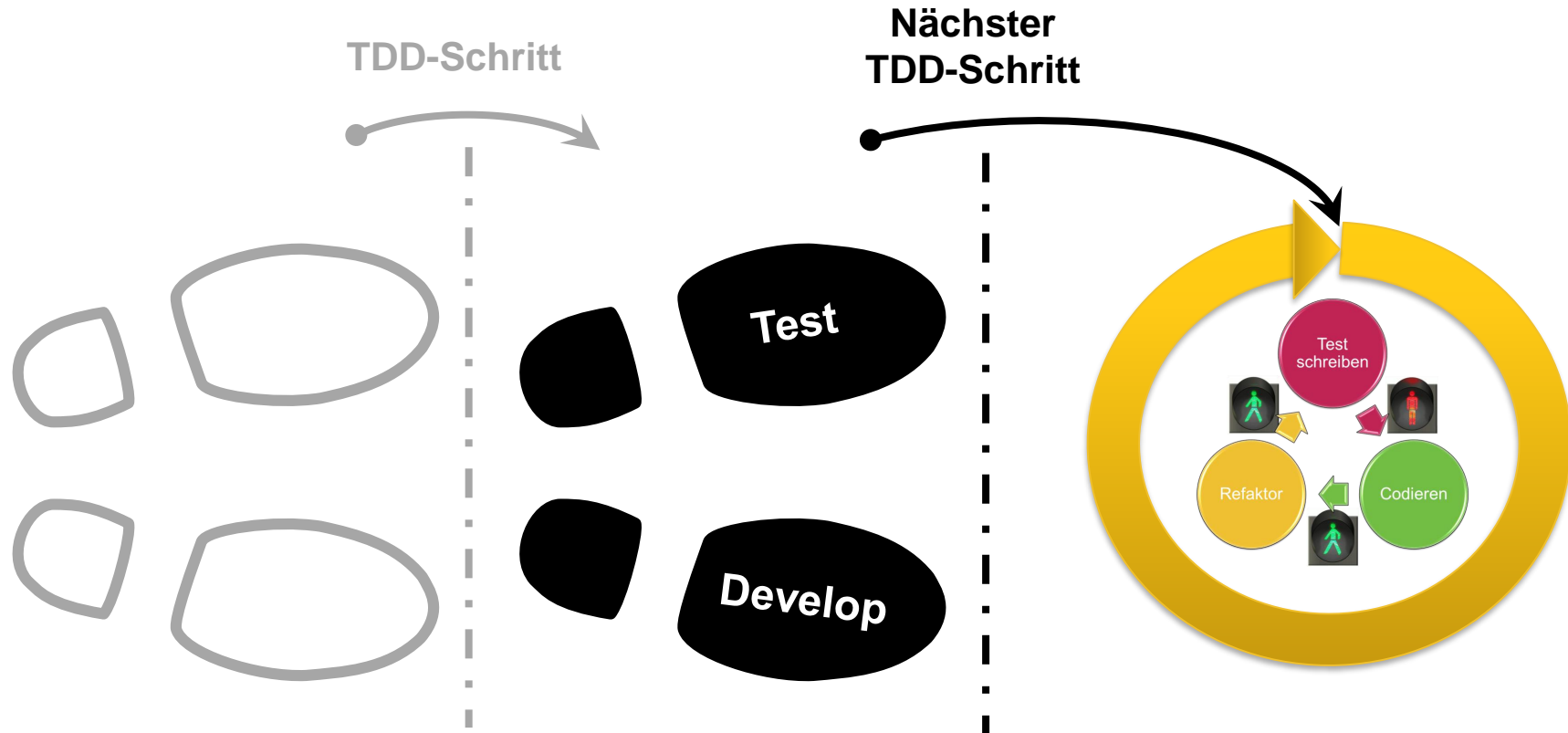
→ Gültiger nächster Schritt: Codieren bis Test gelingt



→ Optionaler nächster Schritt: Refaktorisieren und alle bisher erstellten Tests **MÜSSEN** gelingen



➔ Nächste Runde im TDD Cycle starten



Embedded Test-Driven Development

Test-Driven Development =>

- Viele kleine Änderungen
- Tests erstellen
- Code Stück für Stück inkrementell erweitern
- TDD Cycle: Test-Code-Test-Code.....Refactoring

TDD von Embedded Systemen =>

Hindernisse bekannt als „**Das Target Hardware Bottleneck**“

- Test Suiten auf dem Embedded System
- Lange Upload Zyklen
- Knappe Ressourcen
- Späte Verfügbarkeit des Target-Systems

TDD von Embedded Systemen

Spezielle Strategien => Überwindung der Hindernisse

Dual Targeting

- Von Tag 1 an
- Codierung für ≥ 2 Plattformen
 - Entwicklungs-Plattform
 - Target-Plattform
- Ermöglicht Entwicklung mit konstanterer Geschwindigkeit
- Vermeidet Probleme mit Anhäufung von ungetestetem Code
- Umgehung des Hardware Bottlenecks
- Erlaubt Testen von Code vor Verfügbarkeit der Target-Hardware

Positiver Seiteneffekt:

- Beeinflusst das Design
 - Mehr Augenmerk auf klare HW-un-/abhängige Strukturierung
- => saubereres Layering der Software
- => später leichter auf andere Systeme portierbar

Embedded TDD Strategien

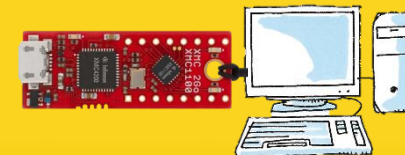
1 Test on Host



2 Test on Target



3 Remote Testing



Quelle: Test-Driven Development Strategies applied to Embedded Software,
Cordemans, Piet, Boydens, Jeroen, Van Landschoot, Sille, Steegmans, Eric, 30. Januar 2012

1

Test on Host



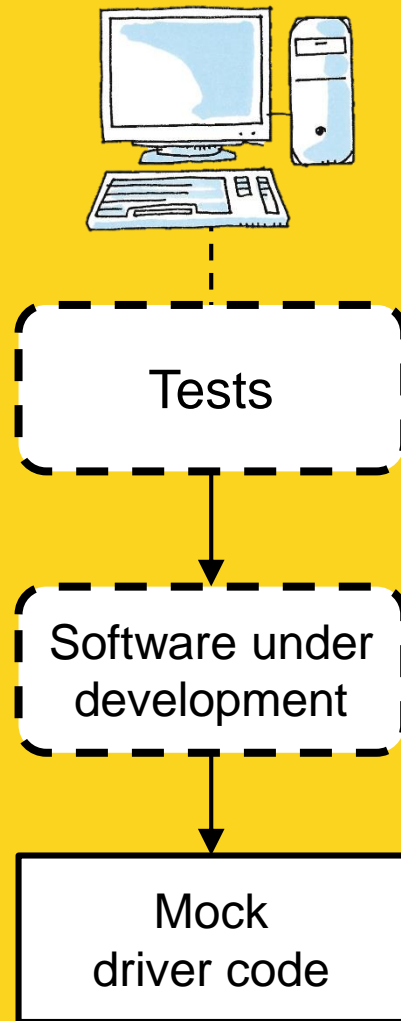
- Durchführung der Tests auf der Entwicklungsumgebung
- Ersetzen der Hardware Abhängigkeiten durch Mocks
- Verifizieren des Mockverhaltens auf dem Target

3

Remote Testing

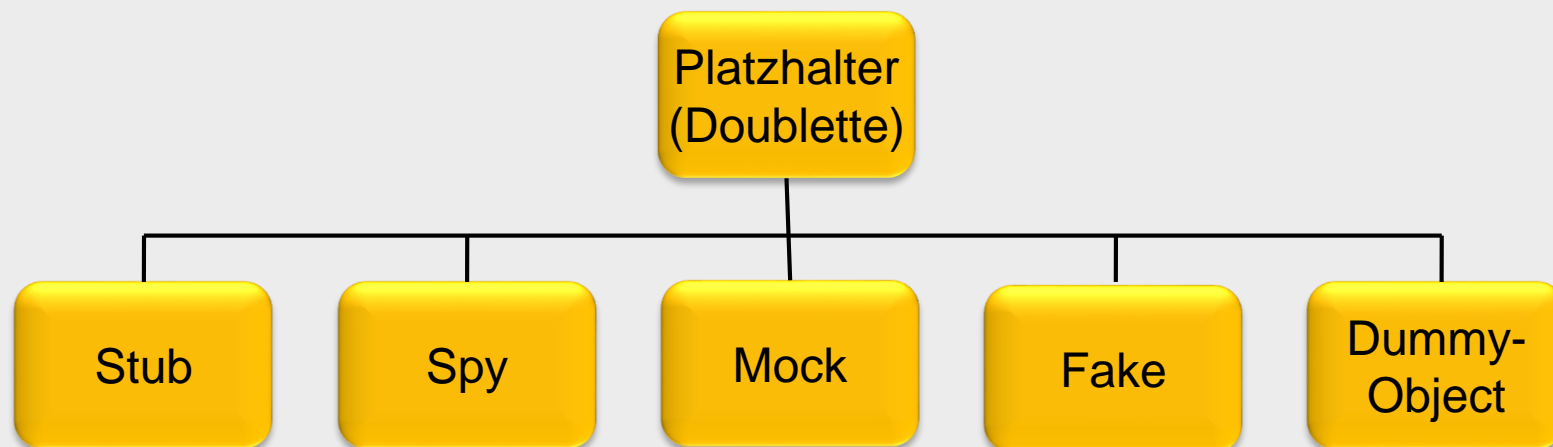


1 Test on Host Strategie



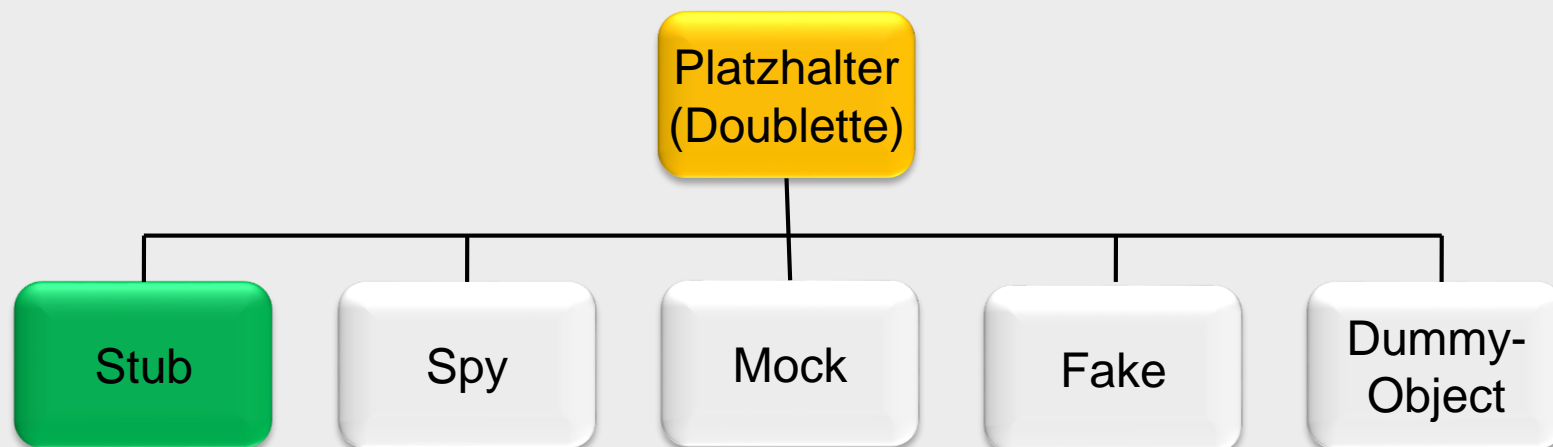
Stubs, Mocks und Dummies

- Möglichst isolierter Test des Testobjektes (Modul, Funktion)
- Ersatz der Abhängigkeiten des Testobjektes durch Platzhalter
- Bereitstellung noch nicht implementierter Teile
- Verschiedene Platzhaltertypen:



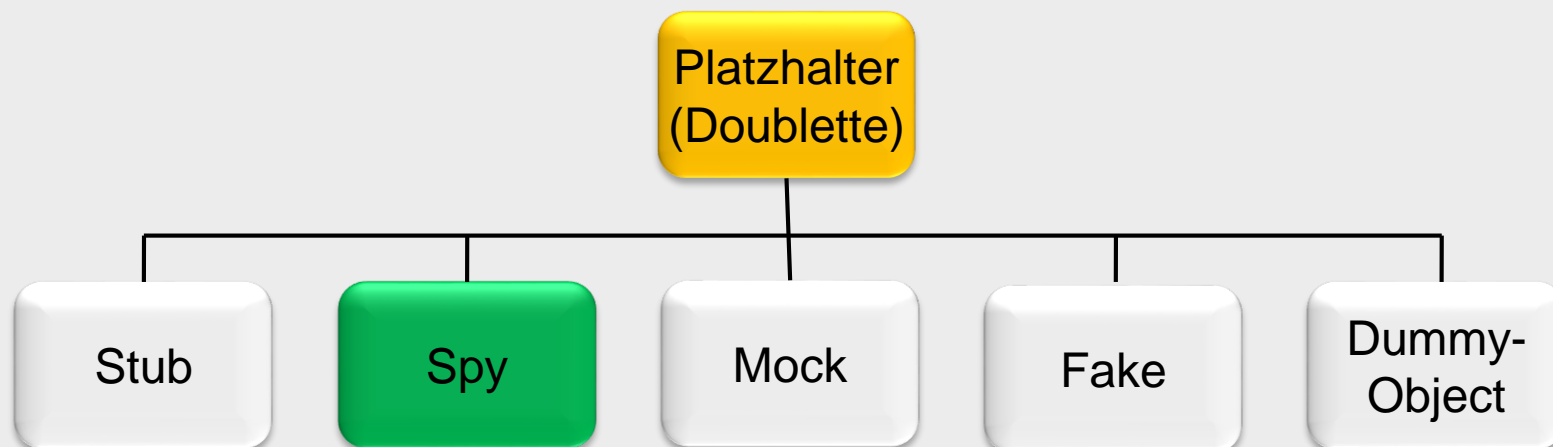
Stubs

- Identisches Interface
- Reaktionen nach festem, ausgewähltem Muster
- Die Reaktionen werden zu jedem einzelnen Testfall festgelegt
=> zusätzlicher indirekter Test-Input-Parameter (Indirect Input)



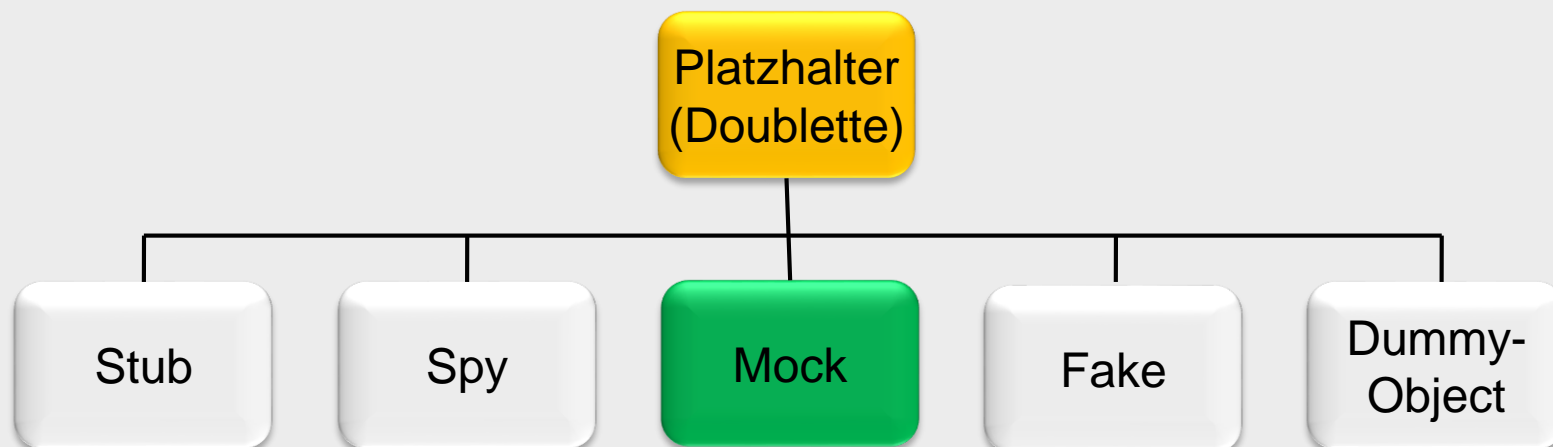
Spy

- Wie Stub, zusätzlich Protokollierung
- „Ausspionieren“ der Aufrufe und übergebenen Daten (Indirect output)
- Protokollierte Daten werden verwendet für
 - Feststellung des Testergebnisses
 - Debugging



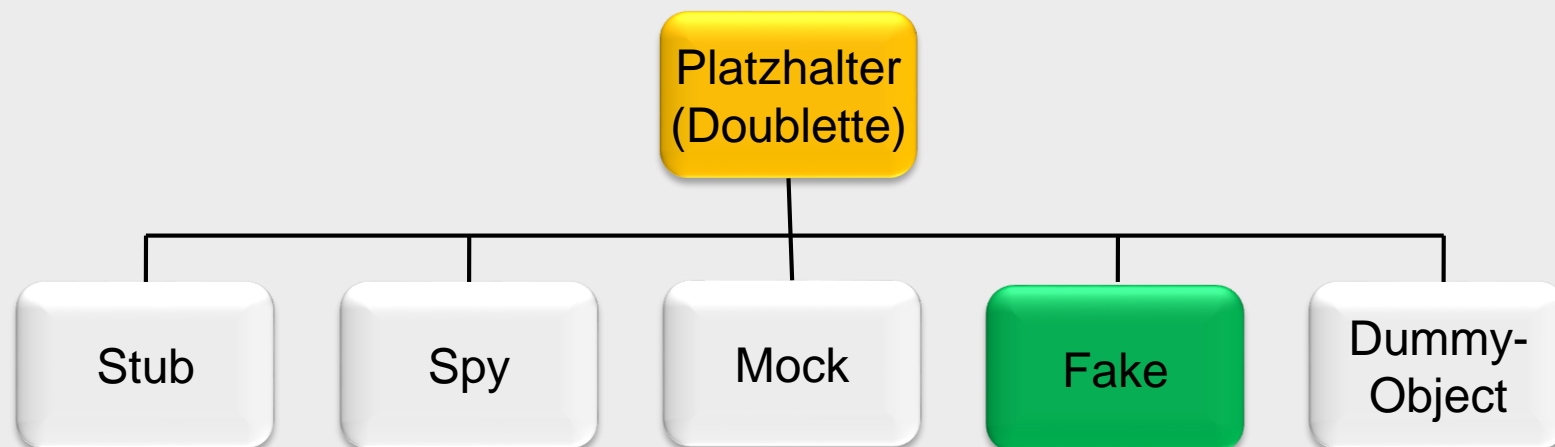
Mock

- Intelligenter Stub
- Auswertung der Aufrufe und übergebenen Daten
- Prüfung auf Zulässigkeit und Korrektheit der Daten
- Reaktion abhängig von der Auswertung der Daten



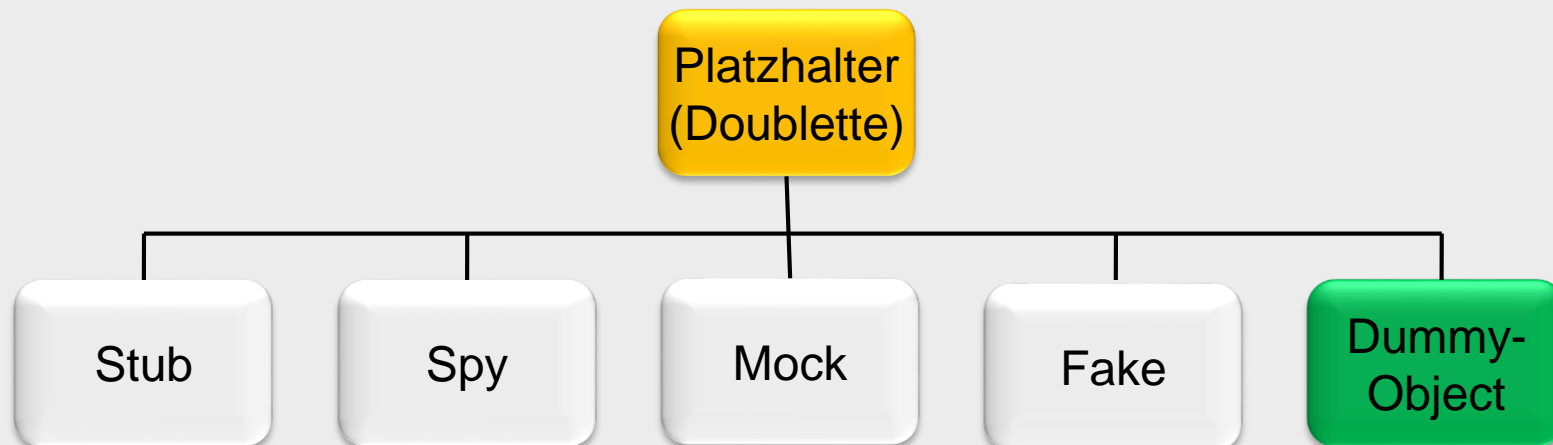
Fake

- Ersetzt eine Komponente von der das Testobjekt abhängig ist
- Stark vereinfachte Implementierung
- Kein weiterer Einfluss auf das Testergebnis

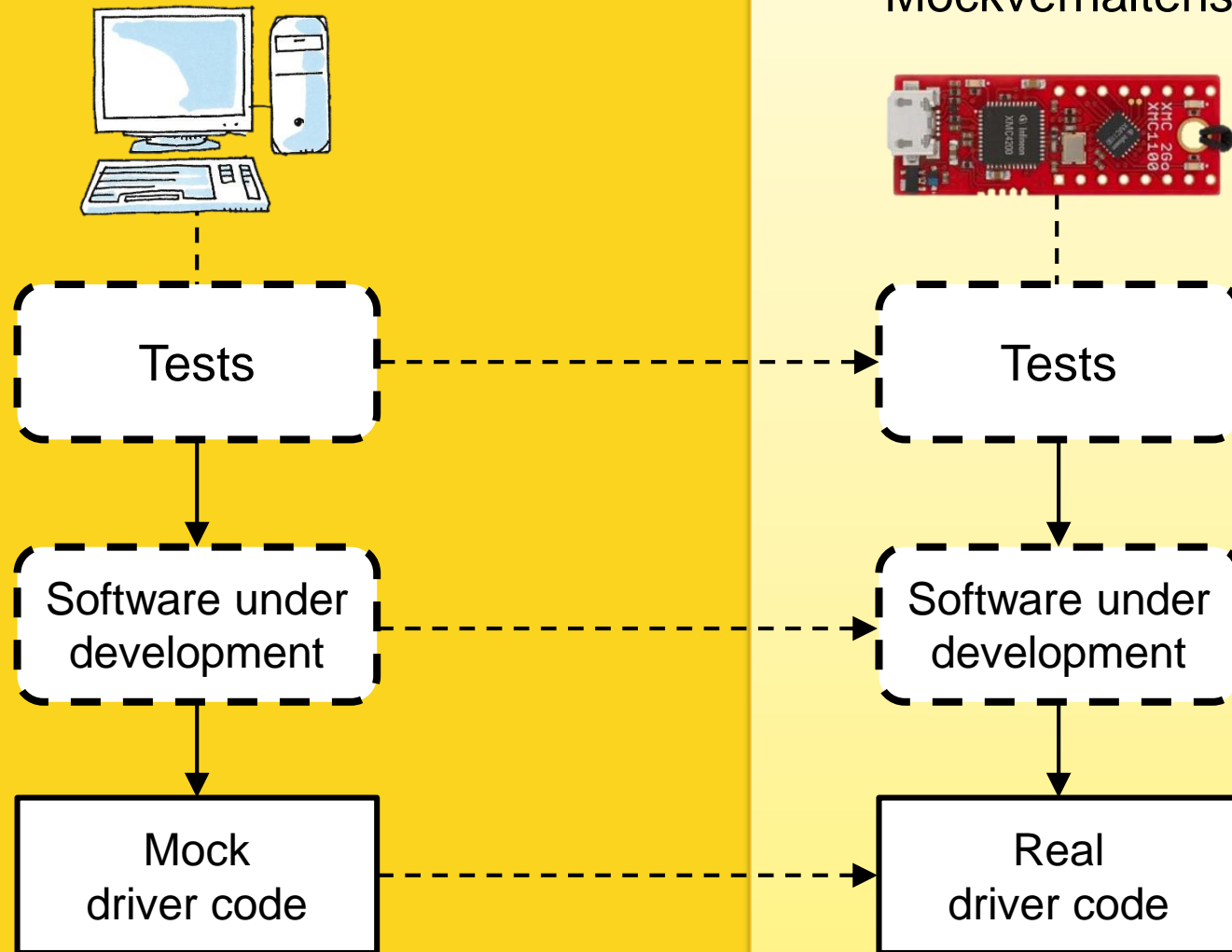


Dummy Object

- Wie Fake nur eben ein Objekt
- Pseudo-Objekt, leeres Objekt, Null-Pointer,
- Kein weiterer Einfluss auf das Testergebnis



1 Test on Host Strategie



1

Test on Host



Vorteile:

- Vermeidet häufige Uploads
- HW-unabhängigen Tests auf dem Host
- „Fake“ des HW-Verhaltens durch Mocks
- Plattform-unabhängige Codierung mit Layer Architektur

Nachteile:

- Kein Real-Time HW Verhalten wegen Mocks
- Keine Abdeckung von Cross-Plattform Problemen (CrossCompiler, Target Datenhaltung, Mockfehler)
- HW-abhängige Tests auf dem Target erforderlich
- Dual Build für Host und Target erforderlich

1

Test on Host



2

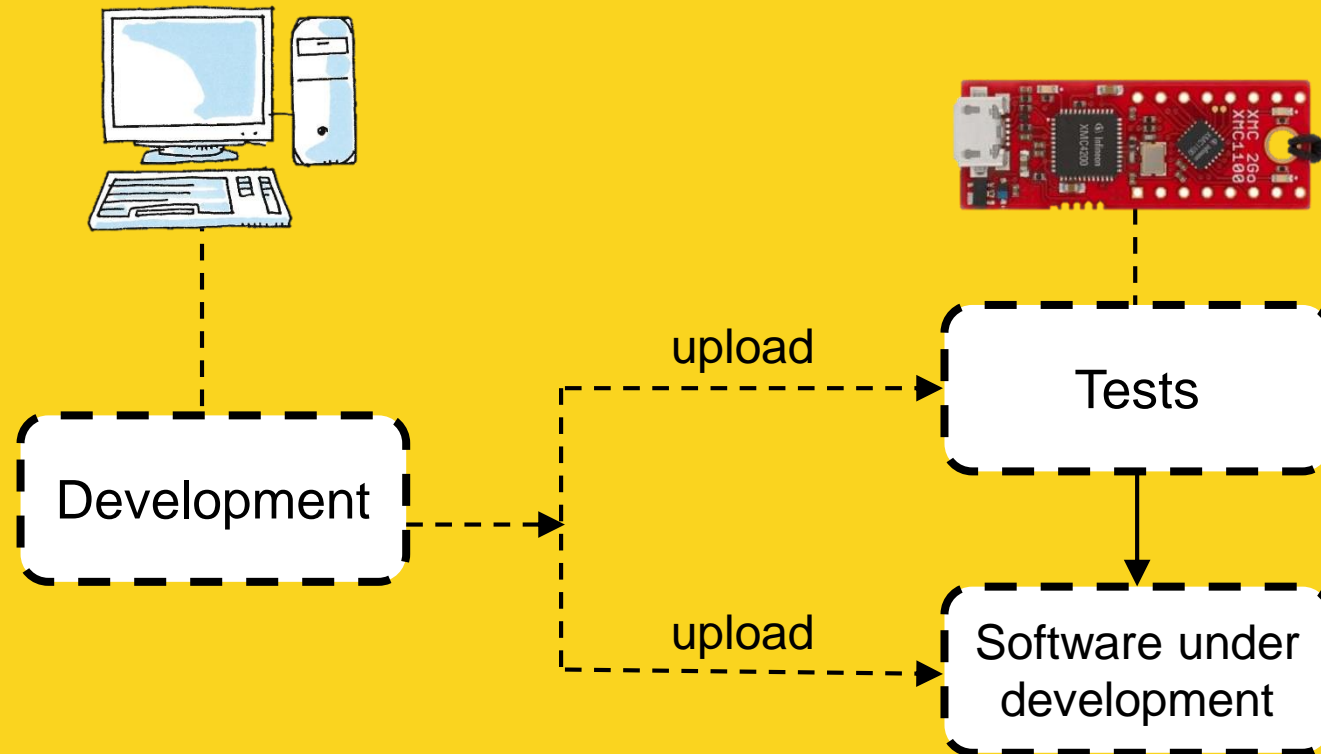
Test on Target



- Tests und Testframework auf dem Target
- Durchführung der hardwareabhängigen Tests auf dem Target



2 Test on Target Strategie



Vorteile:

- Reelle Target Testumgebung
- Test des Real-time Verhaltens möglich
- Einfacher Test zusammen mit Legacy Code
- Komplette Validierung und Verifizierung (sofern ausreichend Ressourcen vorhanden sind)



2

Test on Target



Nachteile:

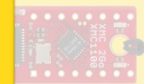
- Häufige Uploads
- Ressourcen für Testumgebung
- Späte Verfügbarkeit des Target-Systems
- Nur für HW-abhängige Tests praktikabel
- Nur im Zusammenspiel mit zusätzlicher Teststrategie



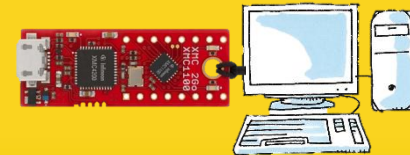
1 Test on Host



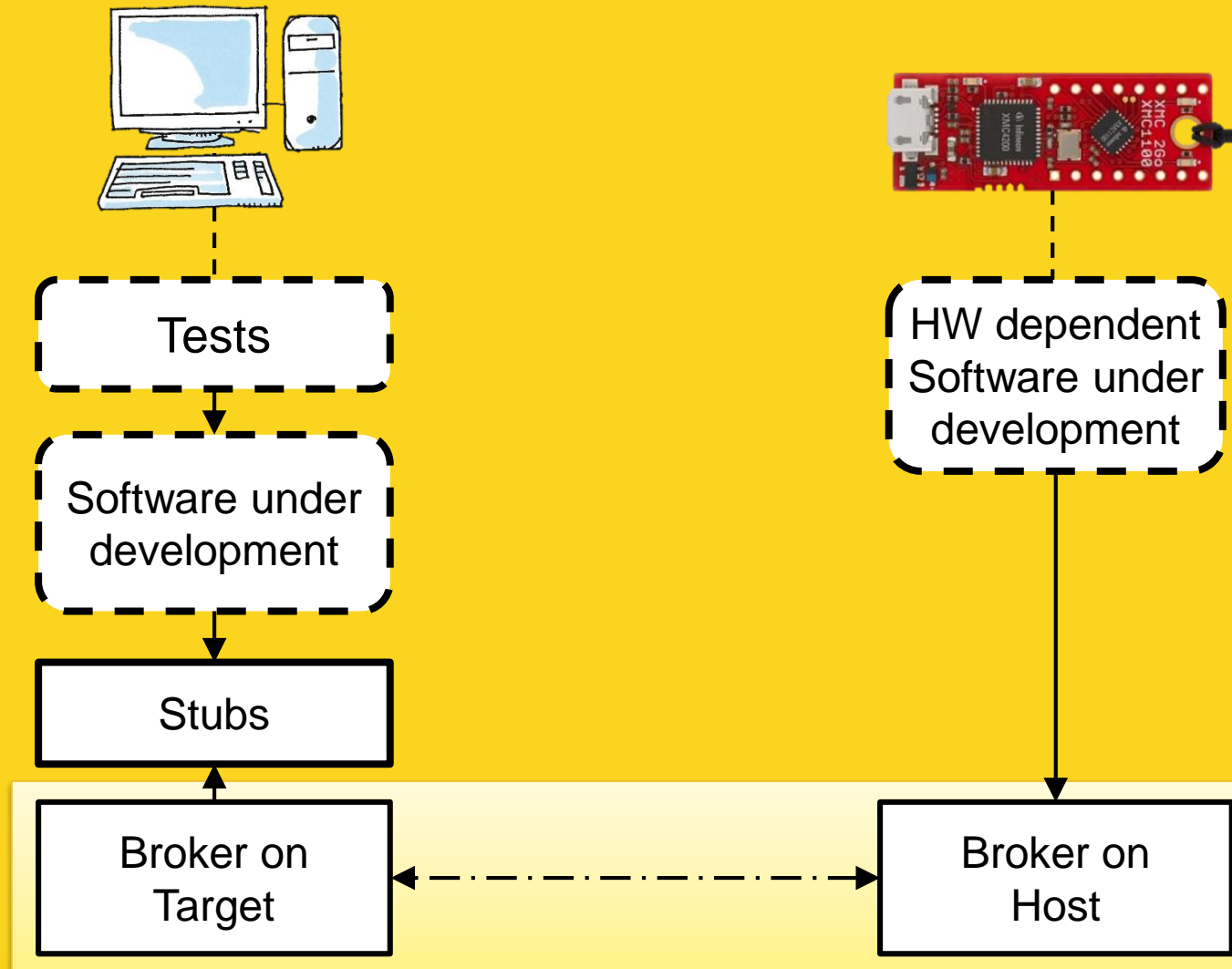
- Inter-Prozess Kommunikation
- Tests und hardwareunabhängiger Code auf dem Host
- Hardwareabhängiger Code läuft auf dem Target



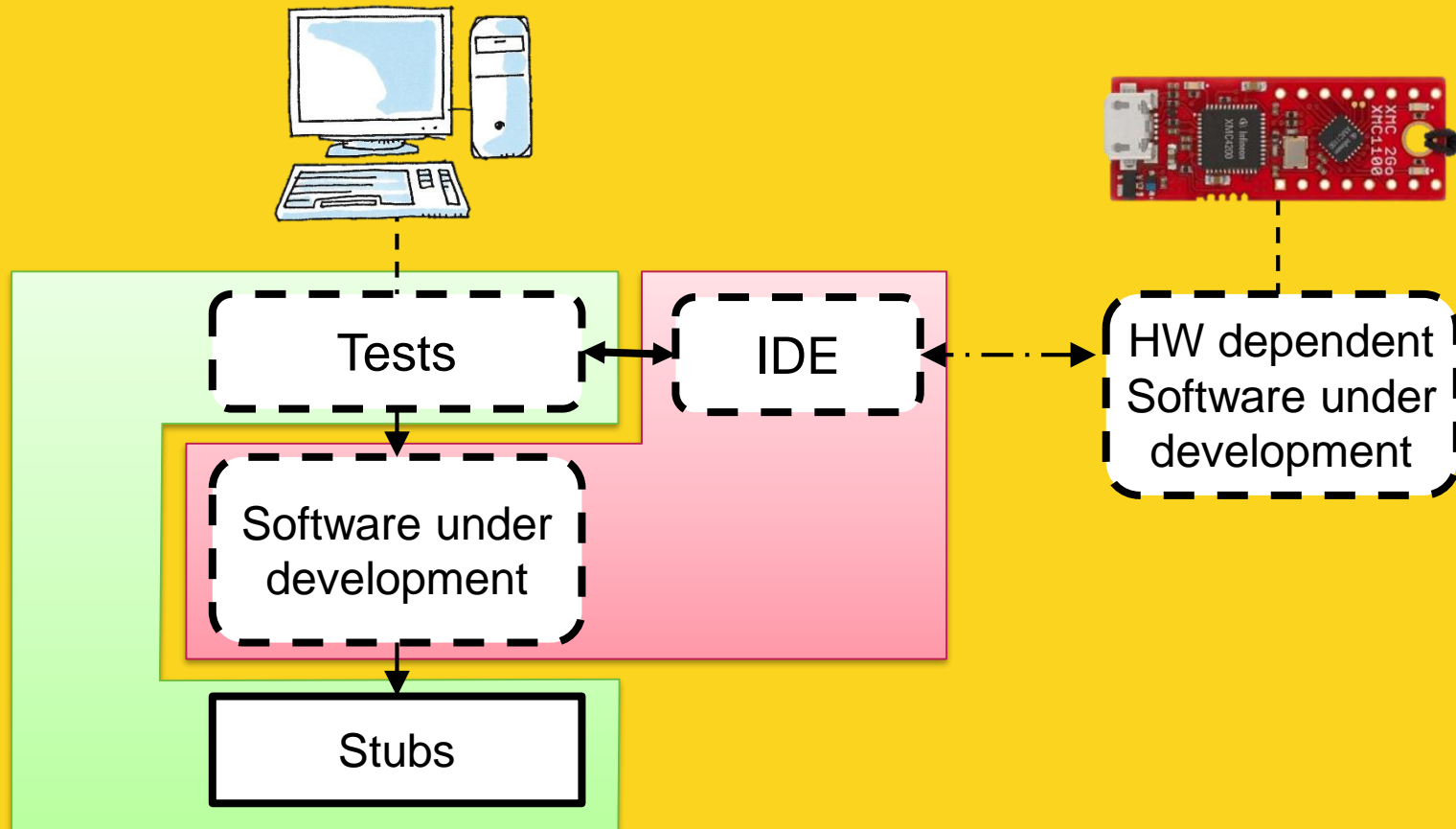
3 Remote Testing



3 Remote Testing Strategie (mit IPC Kommunikation)

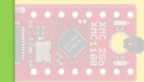


3 Remote Testing Strategie (mit Test-SW <-> IDE Kommunikation)



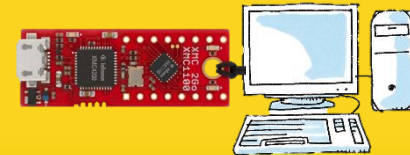
Vorteile:

- Ressourcen für Testumgebung nur auf dem Host
- HW-unabhängigen Tests auf dem Host
- HW-abhängige Tests auf dem Target
- IPC Kommunikation oder
- Unterstützende Test-Software



3

Remote Testing



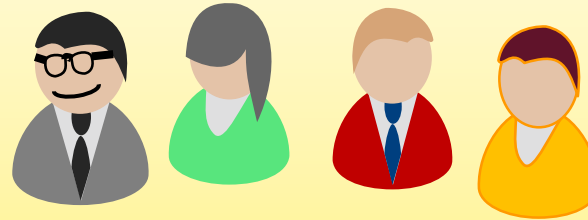
Nachteile:

- Dual Build für Host und Target erforderlich
- Komplexität des Testsystems

Anwendungsmöglichkeit für TDD

Umsetzung individuell:

- TDD
- traditionell



Anwendungsmöglichkeiten:

- Neues Projekt
- Neues Modul
- Erweiterung bestehender Module (*Testliste nicht vergessen!*)

Zusammenfassung Test-First-Ansatz

Ziel: Fehler so früh wie möglich aufdecken

Umsetzung:

- Tests erstellen bevor der jeweilige Testgegenstand existiert
- Tests möglichst früh ausführen
- Test-First lässt sich in allen Teststufen anwenden

- TDD ist die Umsetzung des Test-First-Ansatzes im Komponententest = Inkrementelles Entwickeln der Unit-Tests parallel zur Implementierung
- Die Einhaltung von nur drei Regeln und die richtige Strategie im Umgang mit dem Target-Hardware-Bottleneck ermöglichen TDD auch für Embedded-Systeme

Danke



embedded
Test-First